

(6)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-278513
 (43)Date of publication of application : 27.09.2002

(51)Int.CI. G09G 3/30
 G09G 3/20

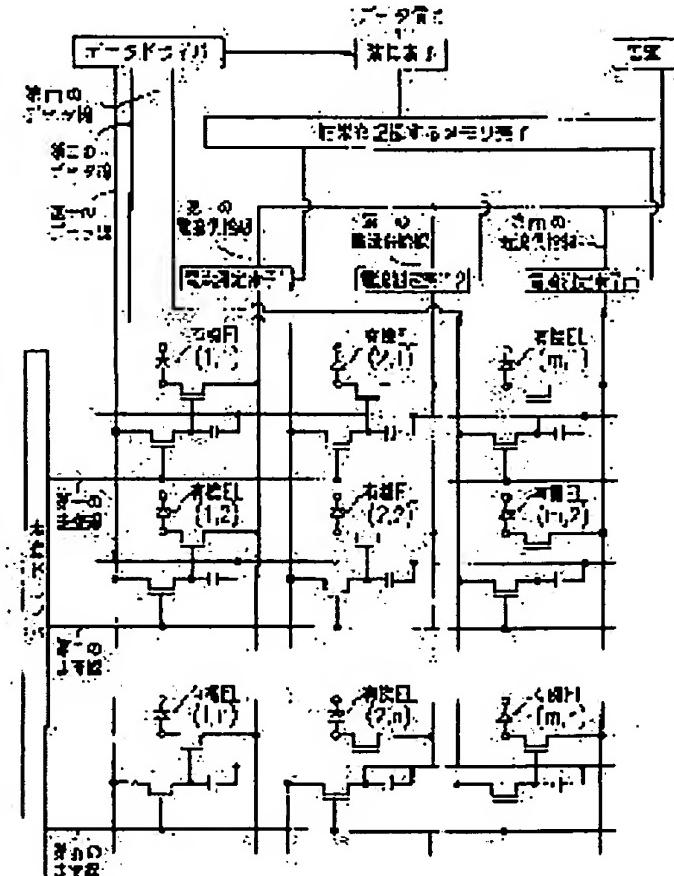
(21)Application number : 2001-079599
 (22)Date of filing : 19.03.2001

(71)Applicant : SHARP CORP
 (72)Inventor : KABE MASAAKI
 NUMAO KOJI
 ITO NOBUYUKI
 MUKAIDONO MITSUHIRO

(54) ELECTRO-OPTICAL DEVICE**(57)Abstract:**

PROBLEM TO BE SOLVED: To correct unevenness in luminance due to deviation in TFT characteristics by measuring the currents that flow in organic EL elements, without providing a current measuring element for each pixel in an active matrix constitution.

SOLUTION: In an electro-optical device, active elements and organic EL elements are arranged in a matrix manner, a plurality of current-supplying wires is arranged to supply currents to the organic EL elements and a current-measuring element is provided for each current supplying wire. A scanning voltage is given to one scanning line, prescribed data voltages are supplied to data lines in synchronism with the scanning voltage and current values that flow in the organic EL elements are measured by the current-measuring elements. Then, the scanning voltage is given to the same scanning line and data signals, which make electro-optical elements in a zero gradation, are supplied to the data lines in synchronism with the scanning voltage. The above drive operations are conducted for each scanning line, and the data voltage to be given to each active element is corrected, based on the obtained current measurement values.

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] 07.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 01.04.2005

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

*** NOTICES ***

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] While the electro-optics component controlled by the active component and this active component on a substrate is arranged in the shape of a matrix It is arranged so that the data line which gives the scanning line and the data electrical potential difference which give a scan electrical potential difference may intersect this active component mutually [near this active component]. Furthermore, two or more current supply source lines for supplying a current to this electro-optics component through this active component are arranged, and it sets to the electro-optic device with which the amperometry component for measuring a current for every current supply source line was prepared. By each amperometry component, give a scan electrical potential difference to the one scanning line in order to measure the current value which flows to each of two or more electro-optics components connected to the current supply source line by which the amperometry component has been arranged, and it synchronizes with the timing. The step which measures the current value which supplies a predetermined data electrical potential difference to each data line, and flows for this electro-optics component by this amperometry component, Give a scan electrical potential difference again to the same scanning line, and the step which supplies the data signal which makes this electro-optics component 0 gradation is performed to each data line to each scanning line synchronizing with the timing. The electro-optic device characterized by amending the data electrical potential difference given to each active component so that the current which flows for each electro-optics component may become equal based on the acquired amperometry value.

[Claim 2] Furthermore, the electro-optic device according to claim 2 characterized by amending the data electrical potential difference given to said active component so that the brightness value of said electro-optics component may be measured in the direction which intersects said current supply source line and the brightness of each electro-optics component may become equal based on the obtained brightness measured value and said amperometry value.

[Claim 3] While the electro-optics component controlled by the active component and this active component on a substrate is arranged in the shape of a matrix It is arranged so that the data line which gives the scanning line and the data electrical potential difference which give a scan electrical potential difference may intersect this active component mutually [near this active component]. Furthermore, it sets to the electro-optic device with which one amperometry component was prepared in order to arrange two or more current supply source lines for supplying a current to this electro-optics component through this active component and to measure the current of this current supply source line. Give a multiple-times scan electrical potential difference to the one scanning line in order to measure the current value which flows to each of two or more electro-optics components by this amperometry component, and it synchronizes with the timing of each time. Supply a predetermined data electrical potential difference to the one respectively different data line, and the data signal which makes this electro-optics component 0 gradation is supplied to the other data lines. Perform the step which measures the current value which flows for this electro-optics component by this amperometry component to each scanning line, and based on the acquired amperometry value, so that the current which flows for each electro-optics component may become equal The electro-optic device characterized by amending the data electrical potential difference given to each active component.

[Claim 4] While the electro-optics component controlled by the active component and this active component on a substrate is arranged in the shape of a matrix It is arranged so that the data line which gives the scanning line and the data electrical potential difference which give a scan electrical potential difference may intersect this active component mutually [near this active component]. Furthermore, it sets to the electro-optic device with which one amperometry component was prepared in order to arrange two or more

current supply source lines for supplying a current to this electro-optics component through this active component and to measure the current of this current supply source line. A TFT component is prepared in a substrate veranda rather than this electro-optics component for every current supply source line. In order to measure the current value which flows to each of two or more electro-optics components by this amperometry component By supplying a predetermined data electrical potential difference to each data line, and scanning sequentially said TFT component prepared for every current supply source line, while giving a scan electrical potential difference to the one scanning line Perform the step which carries out sequential measurement of the current value which flows for this electro-optics component by this amperometry component to each scanning line, and based on the acquired amperometry value, so that the current which flows for each electro-optics component may become equal The electro-optic device characterized by amending the data electrical potential difference given to each active component.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]**[0001]**

[Field of the Invention] This invention relates to the electro-optic device which used electro-optics components, such as an organic EL device.

[0002]

[Description of the Prior Art] Since an organic EL device is a spontaneous light corpuscle child who emits light himself, without needing the light source for others, when this is applied to a display, it hides possibility of enduring liquid crystal and that the thin display on which a wide-field-of-view angle is acquired by high contrast will be obtained.

[0003] Drawing 1 is the outline sectional view showing the structure of a common organic EL device. Here, the laminating of an anode plate 2, a hole injection layer 3, the electron hole transportation layer 4, a luminous layer 5, the electronic transportation layer 6, and the cathode 7 is carried out to order on the substrate. And an electron is poured in for a hole (electron hole) from cathode 7 from an anode plate 2 by impressing direct current voltage to two electrodes 2 and 7. In case 1-fold term excitation state of a fluorescence molecule is generated by these two recombination and that singlet excited molecule returns to a ground state by it, it is the principle that luminescence of an organic EL device is obtained according to a series of processes in which light is emitted outside.

[0004] The property of the common organic EL device to drawing 2 (a) - drawing 2 (c) is shown. Drawing 2 (a) shows the relation between applied voltage and brightness, drawing 2 (b) shows the relation between applied voltage and a current, and drawing 2 (c) shows the relation between applied voltage and luminous efficiency. If brightness becomes more than a certain threshold voltage, it will increase gradually, and if current density also becomes more than a certain threshold voltage, it will increase gradually. Moreover, luminous efficiency serves as maximum in a certain electrical potential difference.

[0005] In recent years, the display of the passive-matrix configuration which used the organic EL device, and a active-matrix configuration is developed briskly.

[0006] The circuitry of the display of a passive-matrix configuration general to drawing 3 is shown. Here, an organic EL device is arranged in the shape of a matrix, and the data line connected with the scanning line connected to the scan driver at the data driver crosses mutually (it intersects perpendicularly in this example), and is formed. The scanning line is connected to the cathode of an organic EL device, and the data line is connected to the anode plate of an organic EL device.

[0007] In the display of this passive-matrix configuration, the organic EL device by which only the period which has chosen each scanning line was connected to it emits light. For this reason, if the number of the scanning line increases and duty ratio goes up, the period which has chosen each scanning line will become short, and the lighting time amount of each pixel will become short, consequently brightness reduction of a display will be caused. If the applied voltage to an organic EL device is increased and the brightness of each pixel is raised in order to avoid this, since luminous efficiency falls so that it becomes a high voltage, generally it will cause increase of power consumption.

[0008] The circuitry of the display of a active-matrix configuration general to drawing 4 is shown. Here, the organic EL device and the active component which controls it are arranged in the shape of a matrix. As shown in drawing 5, two kinds, the switching TFT which is TFT n channels, and the driving TFT which is TFT p channels, are required for an active component. Moreover, the data line which gives the scanning line and the data electrical potential difference (data signal) which give a scan electrical potential difference (signal which opens the gate) to this active component crosses mutually (it intersects perpendicularly in this example), is formed, and is respectively connected to the scan driver and the data driver. Furthermore, the

current supply source line for supplying a current to an organic EL device through an active component is formed in parallel with the data line.

[0009] In the display of this active-matrix configuration, the gate signal of Switching TFT is inputted from the scanning line, and the charge of an amount according to a data signal is inputted into a capacitor from the data line synchronizing with this. According to the amount of charges accumulated in this capacitor, the resistance between the source drains of Driving TFT is determined, a current is supplied to an organic EL device from a current supply source line, and an organic EL device emits light. And since a current supply source is carried out to an organic EL device from a current supply source line through Driving TFT even after Switching TFT is closed, it becomes possible to make an organic EL device emit light till the next scan. For this reason, since it can drive by the low battery so that brightness reduction of a display may not be caused even if duty ratio goes up, low-power-ization is attained. Moreover, it is also possible for the resistance between source drains to be decided according to the data signal from the data line in this configuration, for the brightness according to a data signal to be obtained since the amount of currents supplied to an organic EL device by this is decided, and to perform a gradation display.

[0010] Thus, since low-power-ization can be attained on the display of a active-matrix configuration compared with a passive-matrix configuration, it is desirable. However, with a active-matrix configuration, for property dispersion of Driving TFT, the amounts of currents which flow to an organic EL device in each pixel differed, and there was a fault that brightness unevenness occurred.

[0011] In order to avoid this, input an indicative data into EL display panel beforehand, a full screen is made to turn on, the brightness of each pixel at that time is measured, the average of this measured value is computed, that difference is computed further, and amendment information memory is made to memorize by making that difference into correction value in JP,11-282420,A. And display dispersion is amended by adding the correction value to an indicative data (data signal) with an adder, and inputting into EL display panel. Thereby, the brightness unevenness of the EL element by property dispersion of TFT can be amended.

[0012] Moreover, the organic EL device deteriorated with luminescence time amount, and also had the problem that luminescence brightness decreased. Generally, since the luminescence frequency for every pixel differs, the pixel with much luminescence frequency becomes dark gradually, and since few [luminescence frequency] pixels have little change, brightness unevenness generates them.

[0013] When each organic EL device is driven with a predetermined electrical-potential-difference value, the current value which flows to an organic EL device is measured, and memory is made to memorize this current value in JP,10-254410,A, in order to avoid this. And the data signal was calculated based on the current value, and it has decided on the luminescence time amount within an one-frame period. Thereby, the brightness unevenness by degradation of an organic EL device can be amended.

[0014] Furthermore, a current detection means to detect the current which flows to each pixel of the organic EL device under lighting is established, and the lighting time amount or lighting current of a pixel is controlled by JP,2000-187467,A according to the detected current. Thereby, the brightness change by dispersion in a component or degradation can be detected, and good gradation control can be performed.

[0015]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In a passive-matrix configuration, for the drive approach which was mentioned above, sequential luminescence is carried out for every pixel on each scanning line, and a current does not flow and emit light to each organic EL device on the scanning line which the scan ended. For this reason, if an amperometry component exists for every data line like JP,2000-187467,A, the current which flows to each organic EL device is detectable.

[0016] However, it was impossible in the former to have applied this technique to a active-matrix configuration. The reason is that it measures the total of a current value which flows to all the organic EL devices connected to the current supply source line when an amperometry component is prepared for every current supply source line since a current is supplied to an organic EL device through Driving TFT even after the scan of Switching TFT was completed.

[0017] For this reason, when it is going to measure the current which flows to the organic EL device of each pixel, the amperometry component needs to be arranged for every pixel like JP,10-254410,A. However, if an amperometry component is arranged for every pixel, since decline in a numerical aperture will be caused and the circuitry of each pixel will also become complicated, it becomes the factor of manufacture yield reduction. Furthermore, since property dispersion is in the amperometry component for every pixel itself, exact current detection is impossible.

[0018] This invention is made so that it may solve the technical problem of such a conventional technique, it

can measure the current which flows for electro-optics components, such as an organic EL device and an inorganic EL element, even if it does not prepare an amperometry component for every pixel in a active-matrix configuration, and aims at offering the electro-optic device which can amend the brightness unevenness by dispersion in a TFT property.

[0019]

[Means for Solving the Problem] While the electro-optics component controlled by the active component and this active component on a substrate is arranged in the shape of a matrix, the electro-optic device of this invention It is arranged so that the data line which gives the scanning line and the data electrical potential difference which give a scan electrical potential difference may intersect this active component mutually [near this active component]. Furthermore, two or more current supply source lines for supplying a current to this electro-optics component through this active component are arranged, and it sets to the electro-optic device with which the amperometry component for measuring a current for every current supply source line was prepared. By each amperometry component, give a scan electrical potential difference to the one scanning line in order to measure the current value which flows to each of two or more electro-optics components connected to the current supply source line by which the amperometry component has been arranged, and it synchronizes with the timing. The step which measures the current value which supplies a predetermined data electrical potential difference to each data line, and flows for this electro-optics component by this amperometry component, Give a scan electrical potential difference again to the same scanning line, and the step which supplies the data signal which makes this electro-optics component 0 gradation is performed to each data line to each scanning line synchronizing with the timing. The data electrical potential difference given to each active component is amended, and the above-mentioned purpose is attained by that so that the current which flows for each electro-optics component may become equal based on the acquired amperometry value.

[0020] According to the above-mentioned configuration, as shown in the operation gestalt 1 mentioned later, it is possible to measure the current value to which an amperometry component flows for each electro-optics component in the configuration prepared for every current supply source line, and to amend a data electrical potential difference (data signal).

[0021] Furthermore, the data electrical potential difference given to said active component may be amended so that the brightness value of said electro-optics component may be measured in the direction which intersects said current supply source line and the brightness of each electro-optics component may become equal based on the obtained brightness measured value and said amperometry value.

[0022] According to the above-mentioned configuration, as shown in the operation gestalt 2 mentioned later, even if dispersion is in the amperometry component itself, it is possible to prevent dispersion arising in the luminescence brightness of an electro-optics component.

[0023] While the electro-optics component controlled by the active component and this active component on a substrate is arranged in the shape of a matrix, the electro-optic device of this invention It is arranged so that the data line which gives the scanning line and the data electrical potential difference which give a scan electrical potential difference may intersect this active component mutually [near this active component]. Furthermore, it sets to the electro-optic device with which one amperometry component was prepared in order to arrange two or more current supply source lines for supplying a current to this electro-optics component through this active component and to measure the current of this current supply source line. Give a multiple-times scan electrical potential difference to the one scanning line in order to measure the current value which flows to each of two or more electro-optics components by this amperometry component, and it synchronizes with the timing of each time. Supply a predetermined data electrical potential difference to the one respectively different data line, and the data signal which makes this electro-optics component 0 gradation is supplied to the other data lines. Perform the step which measures the current value which flows for this electro-optics component by this amperometry component to each scanning line, and based on the acquired amperometry value, so that the current which flows for each electro-optics component may become equal The data electrical potential difference given to each active component is amended, and the above-mentioned purpose is attained by that.

[0024] According to the above-mentioned configuration, as shown in the operation gestalt 3 mentioned later, it is possible to measure the current value which flows for each electro-optics component by one amperometry component, and to amend a data electrical potential difference (data signal).

[0025] While the electro-optics component controlled by the active component and this active component on a substrate is arranged in the shape of a matrix, the electro-optic device of this invention It is arranged so that the data line which gives the scanning line and the data electrical potential difference which give a scan

electrical potential difference may intersect this active component mutually [near this active component]. Furthermore, it sets to the electro-optic device with which one amperometry component was prepared in order to arrange two or more current supply source lines for supplying a current to this electro-optics component through this active component and to measure the current of this current supply source line. A TFT component is prepared in a substrate veranda rather than this electro-optics component for every current supply source line. In order to measure the current value which flows to each of two or more electro-optics components by this amperometry component By supplying a predetermined data electrical potential difference to each data line, and scanning sequentially said TFT component prepared for every current supply source line, while giving a scan electrical potential difference to the one scanning line Perform the step which carries out sequential measurement of the current value which flows for this electro-optics component by this amperometry component to each scanning line, and based on the acquired amperometry value, so that the current which flows for each electro-optics component may become equal The data electrical potential difference given to each active component is amended, and the above-mentioned purpose is attained by that.

[0026] According to the above-mentioned configuration, as shown in the operation gestalt 4 mentioned later, it becomes possible to measure the current value which flows for each electro-optics component by one amperometry component, and to amend a data electrical potential difference (data signal).

[0027]

[Embodiment of the Invention] Below, the gestalt of operation of this invention is explained, referring to a drawing.

[0028] (Operation gestalt 1) Drawing 6 is a circuit diagram for explaining the configuration of the organic EL panel which is 1 operation gestalt of the electro-optic device of this invention. The organic EL device with which this organic EL panel is controlled by the active component and it at a substrate top is arranged in the shape of a matrix. On the substrate 1, the laminating of an anode plate 2, a hole injection layer 3, the electron hole transportation layer 4, a luminous layer 5, the electronic transportation layer 6, and the cathode 7 is carried out to order, and the organic EL device is constituted, as shown in drawing 1. Moreover, the active component consists of switching TFT, driving TFT, and a capacitor, as shown in drawing 5. Moreover, it is arranged so that the data line which gives the scanning line and the data electrical potential difference which give a scan electrical potential difference may intersect an active component mutually [near the active component]. The scanning line is connected to a scan driver and the data line is connected to the data driver. Furthermore, two or more current supply source lines for supplying a current to an electro-optics component through an active component are arranged.

[0029] Furthermore, with this operation gestalt, the amperometry component for measuring a current for every current supply source line is prepared. As this amperometry component, the thing of a configuration as shown, for example in drawing 18 can be used. The memory device for memorizing an amperometry result is connected to an amperometry component, and the memory device is connected to the data driver through the arithmetic element.

[0030] Next, in the organic EL panel constituted in this way, how to amend the brightness unevenness of the organic EL device by dispersion in a TFT property is explained. First, how to measure the current value which flows to each organic EL device is explained. First, a scan electrical potential difference is given to the first scanning line, and the gate of the switching TFT on the first scanning line is made open.

Synchronizing with this, a predetermined data electrical potential difference (for example, electrical potential difference for realizing the current which corresponds when the division-into-equal-parts rate of the brightness is carried out in a current-brightness property) is inputted through each data line. According to the amount of charges accumulated in the capacitor, it is opened by the gate of Driving TFT by this, and a current flows into the organic EL device on the first scanning line from a current supply source line. The gate voltage of the driving TFT at this time is almost equal to a data electrical potential difference, and the current according to it flows to an organic EL device. The amount of currents which flows to each organic EL device at this time is measured by the amperometry component, and a memory device is made to memorize a measurement result. Then, a scan electrical potential difference is again given to the first scanning line, and the gate of the switching TFT on the first scanning line is made open. Synchronizing with this, it lets each data line pass and the data electrical potential difference which makes an organic EL device 0 gradation is inputted. Thereby, a current will not flow to the organic EL device on the first scanning line. [0031] The above scan is performed about other scanning lines one by one. It enables this to measure all the current values that flow to each organic EL device.

[0032] For example, the amount of currents which flows to each organic EL device on the first data line

(organic electroluminescence (1 1), organic electroluminescence (1 2), ..., organic electroluminescence (1 n)) is measured by the amperometry component 1. As for this amount of currents, when amount of currents is taken along an axis of ordinate, $\log(I)$ (I has dispersion in it, as shown in drawing 7. This is based on property dispersion of Driving TFT. Thus, if the amounts of currents which flow to each organic EL device differ, the brightness obtained will also differ and brightness unevenness will occur.

[0033] Next, this current value dispersion is amended and how to obtain uniform brightness is explained. The current value which flows with gate-voltage: V_{gate} in general TFT: The relation of $\log(I)$ comes to be shown in drawing 8. The part which leans in this drawing 8 is [0034].

[Equation 1]

$$\log(I) = aV_{gate} + b \quad (a \text{ は傾き、} b \text{ は切片}) \quad \dots \quad (1)$$

[0035] It can come out and the straight line expressed can define.

[0036] If the properties of a TFT component differ, as shown in drawing 9, a difference will arise in a property. For this reason, even if it inputs the same gate voltage, dispersion arises in the flowing current value. However, in each TFT, it hardly changes about a of the above-mentioned formula (1). Moreover, in circuitry as shown in drawing 6, it is thought that gate voltage is equal to a data signal (data electrical potential difference).

[0037] Here, in order to simplify explanation, only the current value (drawing 7) which flows to three organic EL devices, the organic electroluminescence (1 1) in drawing 6, organic electroluminescence (1 2), and organic electroluminescence (1 3), is considered, and how to amend brightness based on this is considered. These are the current values which flowed when the same data electrical potential difference (hereafter referred to as V_c), i.e., the same gate voltage, was given to Driving TFT, and are respectively taken as $\log(I_1)$, $\log(I_2)$, and $\log(I_3)$. This -- axis-of-abscissa: -- when it plots in a graph as gate voltage (V_{gate}) and an amount log of axis-of-ordinate: currents (I), it comes to be shown in drawing 10. Since the current characteristic of TFT is known as shown in drawing 8, when it is made to pass each point of drawing 10, it comes to be shown in drawing 11. At this time, the leaning straight line of a part is [0038].

[Equation 2]

$$\text{有機EL(1,1) では、 } \log(I) = aV_{gate} + (\log(I_1) - aV_c) \quad \dots \quad (2)$$

$$\text{有機EL(1,2) では、 } \log(I) = aV_{gate} + (\log(I_2) - aV_c) \quad \dots \quad (3)$$

$$\text{有機EL(1,3) では、 } \log(I) = aV_{gate} + (\log(I_3) - aV_c) \quad \dots \quad (4)$$

[0039] ** -- it is expressed like.

[0040] It is [0041] when it asks for the gate voltage to which the current value of criteria is decided to be the current which flows to organic electroluminescence (1 2), and the same current value as organic electroluminescence (1 2) flows also in organic electroluminescence (1 1) and organic electroluminescence (1 3) from the above-mentioned formula (2) and the above-mentioned formula (4) here, as shown in drawing 7.

[Equation 3]

$$\text{有機EL(1,1) では、 } \frac{\log(I_2) - \log(I_1) + aV_c}{a}$$

$$\text{有機EL(1,3) では、 } \frac{\log(I_2) - \log(I_3) + aV_c}{a}$$

[0042] It becomes. If this gate voltage is respectively inputted into the driving TFT of organic electroluminescence (1 1) and organic electroluminescence (1 3), the same current as organic electroluminescence (1 2) will flow, and uniform brightness will be obtained. In addition, since there is little dispersion between components, a can be beforehand measured by any one TFT.

[0043] Thus, even when the current values which flow when the same data electrical potential difference (gate voltage) is given to Driving TFT differ, the same current is passed to an organic EL device, and it can make it possible to obtain uniform brightness by amending a data electrical potential difference by the easy operation.

[0044] In amendment of other data electrical potential differences (gate voltage of Driving TFT), although the above-mentioned amperometry may be performed again, it can also ask by count using the above-mentioned formula (2) - above-mentioned type (4). For example, the current which flows in organic

electroluminescence (1 2) at the time of gate voltage V_c' is [0045].

[Equation 4]

$$\alpha V_c' + (\log(I_2) - \log(I_1))$$

[0046] It is come out and expressed. It is [0047] when it asks for the gate voltage to which the same current value as organic electroluminescence (1 2) flows from the above-mentioned formula (1) and the above-mentioned formula (3) in organic electroluminescence (1 1) and organic electroluminescence (1 3).

[Equation 5]

有機EL(1,1)では、 $\frac{\log(I_2) - \log(I_1) + \alpha V_c'}{\alpha}$

有機EL(1,3)では、 $\frac{\log(I_2) - \log(I_3) + \alpha V_c'}{\alpha}$

[0048] It becomes. If this gate voltage is respectively inputted into the driving TFT of organic electroluminescence (1 1) and organic electroluminescence (1 3), the same current as organic electroluminescence (1 2) will flow, and uniform brightness will be obtained. Thus, once it performs the amperometry on a certain data electrical potential difference, amendment in other data electrical potential differences can also be performed based on this current value.

[0049] Also in other organic EL devices on the first scanning line, and the organic EL device on other scanning lines, the data electrical potential difference (gate voltage of Driving TFT) on which the same current flows by the easy operation can be determined, and uniform brightness can be obtained by this.

[0050] The amperometry result obtained by the above-mentioned amperometry component is memorized by the memory device which memorizes the result shown in drawing 6, amendment of a data signal is performed by the arithmetic element and the amended data signal is sent to a data driver. The above process can perform a uniform gradation display. In addition, a user can perform [a use front or] the above brightness amendments suitably while in use.

[0051] (Operation gestalt 2) In the above-mentioned operation gestalt 1, brightness amendment of the organic EL device of a direction which met the data line is performed by the current value measured by each amperometry component. Therefore, when there is no dispersion in each amperometry component itself, in all organic electroluminescence, uniform brightness can be obtained by the approach explained with the operation gestalt 1.

[0052] However, when an amperometry component is made by the substrate, property dispersion is in the amperometry component itself, and there is a possibility that dispersion may have arisen in the measurement itself. In this case, even if it amends a data electrical potential difference like the operation gestalt 1, the brightness of an organic EL device differs in the direction (direction which crosses a current supply source line) which met the scanning line. For example, in organic electroluminescence (1 1), organic electroluminescence (2 1), ..., organic electroluminescence (m, 1), even if it inputs a data electrical potential difference so that brightness may become the same, brightness will differ.

[0053] In order to amend property dispersion of this amperometry component itself, after inputting the predetermined data electrical potential difference amended by performing amendment like the operation gestalt 1, as shown in drawing 12, the measurement of luminance of a pixel is performed to the direction which met the scanning line. By this measurement of luminance, the case where the brightness of organic electroluminescence (1 1), organic electroluminescence (2 1), ..., organic electroluminescence (m, 1) comes to show drawing 13 is considered.

[0054] Below, organic electroluminescence (1 1) and organic electroluminescence (2 1) are considered for simplification of explanation. The current-brightness property of organic electroluminescence can be mostly approximated in a straight line, as shown in drawing 14. Here, the brightness of organic electroluminescence (1 1) is made into the brightness K2 of K1 and organic electroluminescence (2 1), and the current value at that time is set to IK1 and IK2. Moreover, gate voltage of the driving TFT of VK1 and organic electroluminescence (2 1) is set to VK2 for the gate voltage of the driving TFT of the organic electroluminescence (1 1) in this brightness. In this case, gate voltage and the relation of the current which flows to organic electroluminescence become a thing as shown in drawing 15.

[0055] Therefore, it is the gate voltage of the driving TFT of organic electroluminescence (1 1) by the same view as the above-mentioned operation gestalt 1, using the intensity level of organic electroluminescence (1 1) as criteria brightness [0056]

[Equation 6]

$$\frac{\log(I_{K2}) - \log(I_{K1}) + \alpha V_{K1}}{a}$$

[0057] If it is alike and carries out, the current value which flows to organic electroluminescence (1 1) and organic electroluminescence (2 1) is in agreement, and brightness can be made the same. Also in other organic EL devices on the first data line, the same brightness as the organic EL device on the second data line is obtained by amending like the above.

[0058] Thus, property dispersion is in the amperometry component itself, and also when dispersion has arisen in the luminescence brightness of an organic EL device in the direction which met the scanning line, uniform brightness can be obtained by amending as mentioned above.

[0059] (Operation gestalt 3) This operation gestalt explains the example which measures the current which flows to each organic EL device by one amperometry component, as shown in drawing 16. In this case, synchronizing with the scan of the scanning line, the current which flows to each organic EL device cannot be measured by having given the predetermined electrical potential difference to all the data lines like the operation gestalt 1. So, with this operation gestalt, the current which flows to an organic EL device with the following procedures is measured.

[0060] First, a scan electrical potential difference is given to the first scanning line, and the gate of the switching TFT on the first scanning line is made open. Synchronizing with this, a predetermined data electrical potential difference is inputted into the first data line, and the data electrical potential difference which makes an organic EL device 0 gradation is inputted into the other data line. Thereby, the current which flows to organic electroluminescence (1 1) can be measured by the amperometry component. Then, a scan electrical potential difference is again given to the first scanning line, and the gate of the switching TFT on the first scanning line is made open. Synchronizing with this, a predetermined data electrical potential difference is inputted into the second data line, and the data electrical potential difference which makes an organic EL device 0 gradation is inputted into the other data line. Thereby, the current which flows to organic electroluminescence (1 2) can be measured by the amperometry component. the current which flows to each organic EL device on the first scanning line can be measured by one amperometry component by boiling, attaching and repeating the above processing to other data lines successively. What is necessary is just to perform the above processing about other scanning lines one by one, in case the current which flows to each organic EL device on other scanning lines is measured. It enables this to measure all the current values that flow to each organic EL device.

[0061] Thus, a uniform gradation display can be obtained by saving the current value which flows to each obtained organic EL device in memory, and amending a data electrical potential difference, as shown in the above-mentioned operation gestalt 1 based on this.

[0062] (Operation gestalt 4) This operation gestalt explains other examples which measure the current which flows to each organic EL device by one amperometry component, as shown in drawing 17. Here, the TFT component is arranged for every current supply source line. The amperometry approach in this case is explained below.

[0063] In the initial state, the gate of the TFT component arranged at each current supply source line is closed. In the condition, first, a scan electrical potential difference is given to the first scanning line, the gate of the switching TFT on the first scanning line is made open, and a predetermined data electrical potential difference is inputted into the first data line synchronizing with this. Thereby, although the gate of the driving TFT on the first scanning line is opened, since all the gates of TFT arranged at each current supply source line are closed, a current does not flow to the organic EL device on the first scanning line. Next, the gate of TFT arranged at the first current supply source line is made open. Thereby, a current flows only to an organic EL device (1 1). The current at this time is measured by the amperometry component. Then, the current value which flows to each organic EL device on the first scanning line can be measured by one amperometry component by making open TFT arranged one by one at the second current supply source line, TFT arranged at the third current supply source line, ..., the gate, and measuring the current which flows to each organic EL device at this time. Then, the first scanning line is scanned again and the data electrical potential difference from which an organic EL device serves as 0 gradation through each data line is inputted. And it becomes possible to measure all of the second scanning line, the third scanning line, and the current value that flows to each organic EL device by repeating the above processing successively with ...

[0064] Thus, a uniform gradation display can be obtained by saving the current value which flows to each obtained organic EL device in memory, and amending a data electrical potential difference, as shown in the above-mentioned operation gestalt 1 based on this.

[0065] In addition, although the above-mentioned operation gestalt explained the example of the electro-optic device which used the organic EL device as an electro-optics optical element, this invention is applicable also to the electro-optic device which used the inorganic EL element.

[0066]

[Effect of the Invention] As explained in full detail above, even when an amperometry component is prepared for every current supply source line in the organic EL device of a active-matrix configuration according to this invention, the current which flows to each organic EL device can be measured, and brightness dispersion can be amended using this current value. Furthermore, even when only one amperometry component is prepared, the current which flows to each organic EL device can be measured, and brightness dispersion can be amended using this current value. Therefore, compared with the conventional technique which needs to arrange the amperometry component for every pixel, a numerical aperture is improved, circuitry can be simplified and the yield can be raised. Furthermore, amperometry dispersion by property dispersion of an amperometry component can be prevented, and current detection can be performed correctly.

[Translation done.]

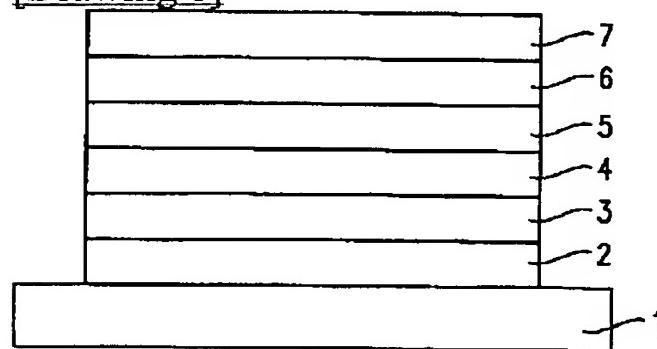
* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

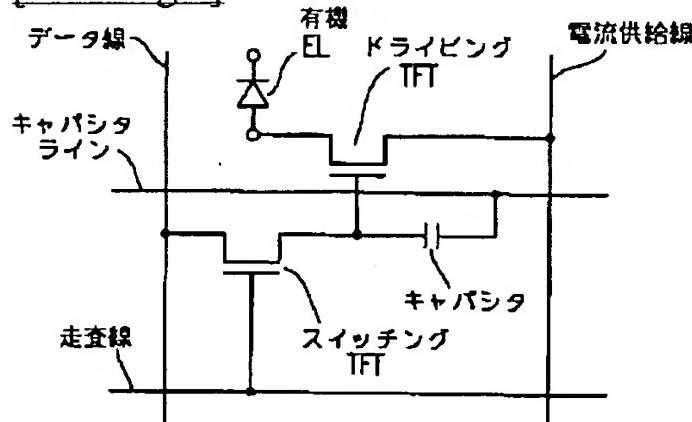
1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

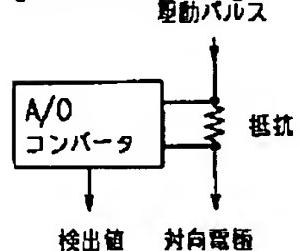
[Drawing 1]



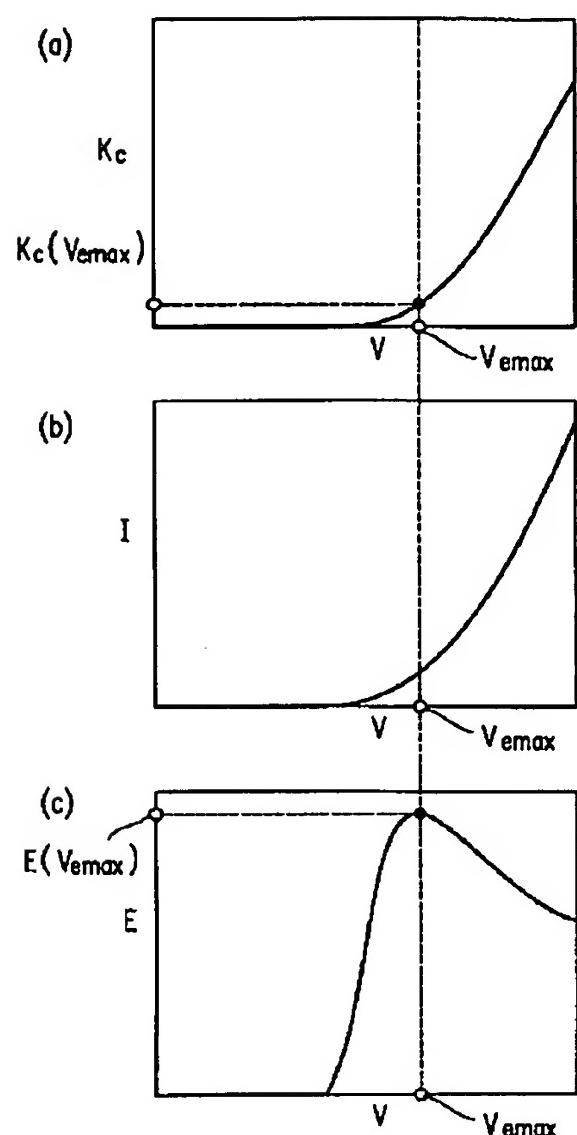
[Drawing 5]



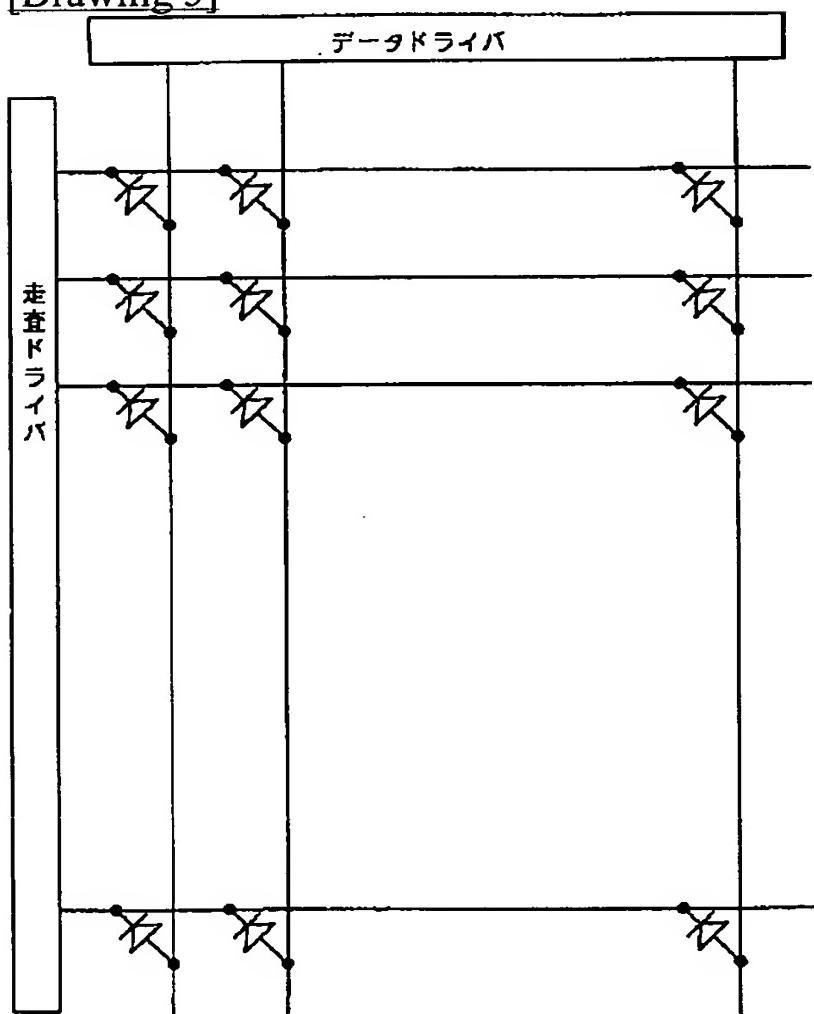
[Drawing 18]



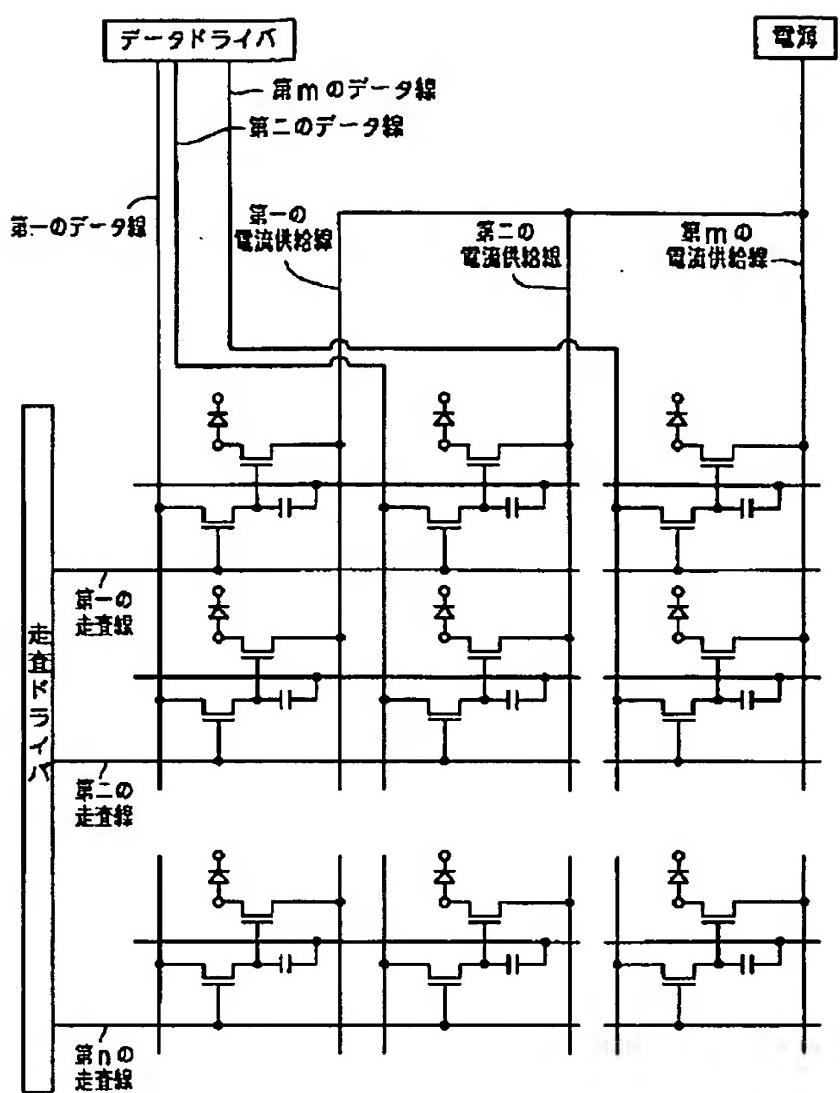
[Drawing 2]



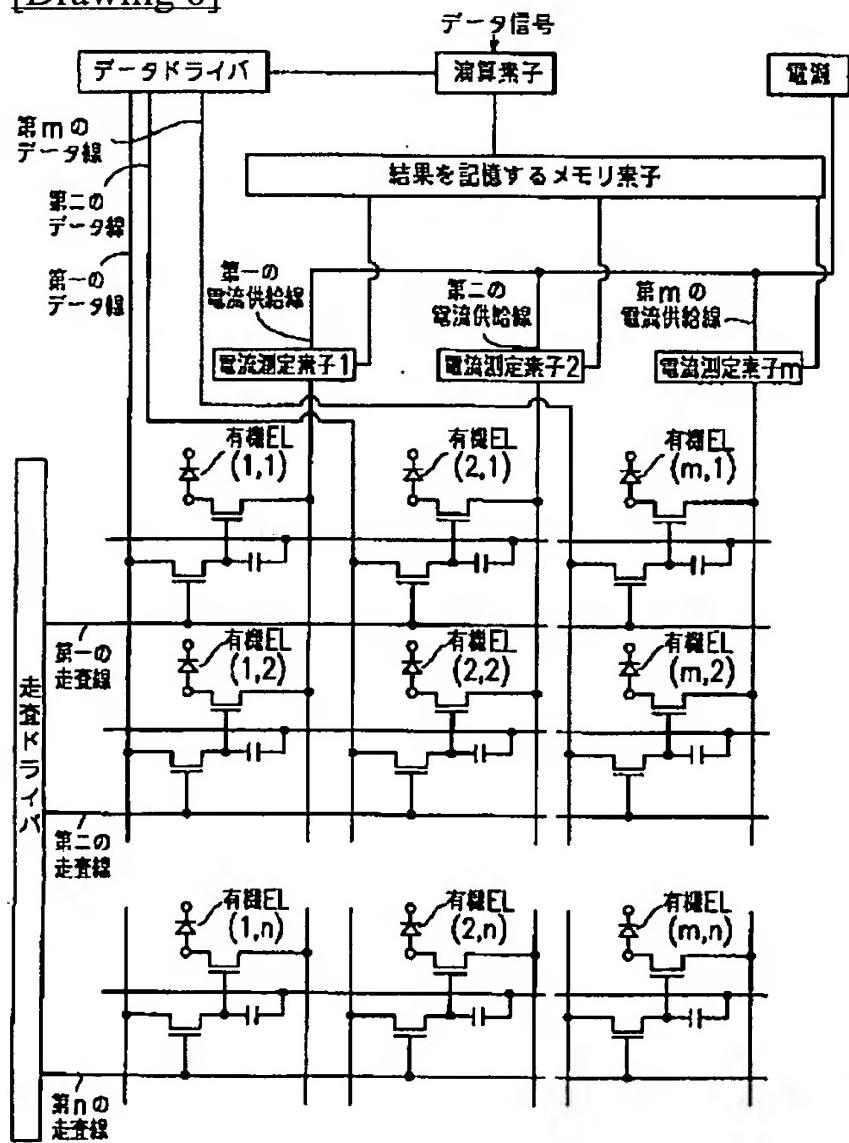
[Drawing 3]



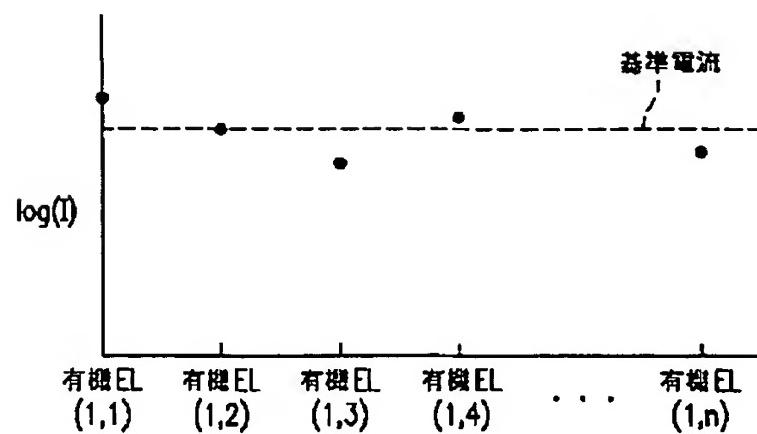
[Drawing 4]



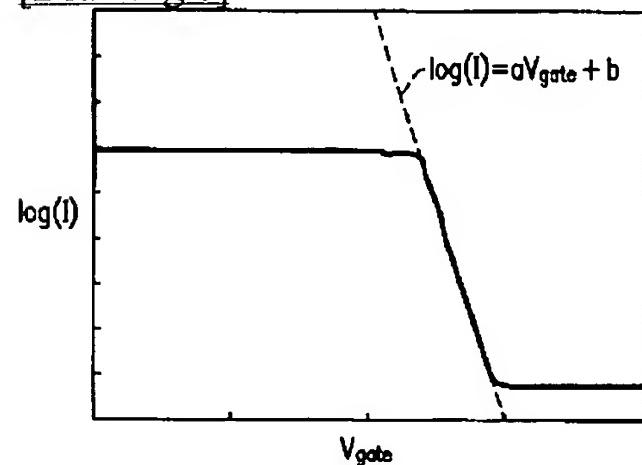
[Drawing 6]



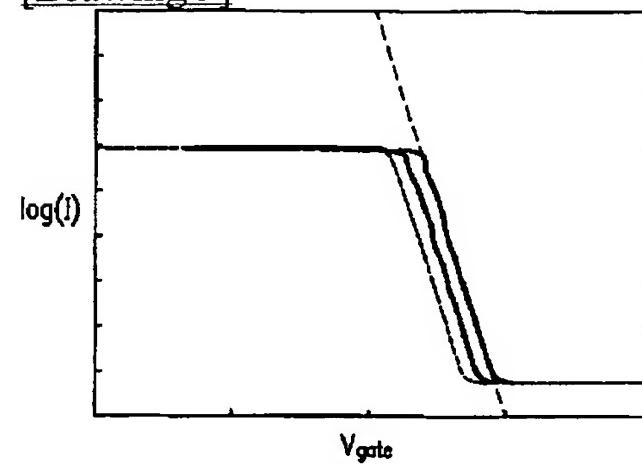
[Drawing 7]



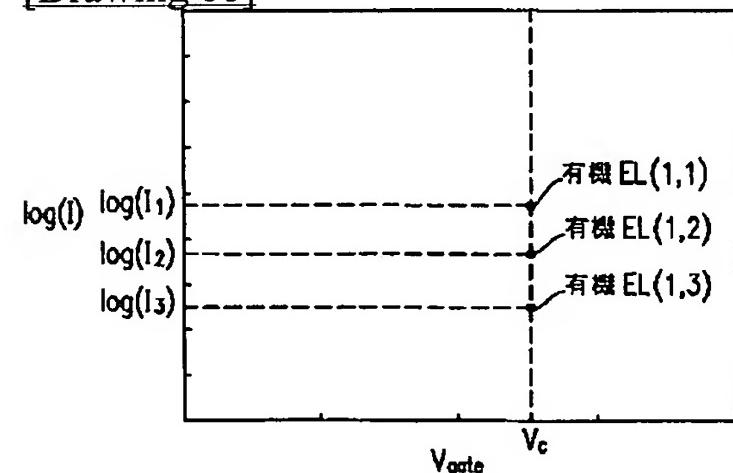
[Drawing 8]



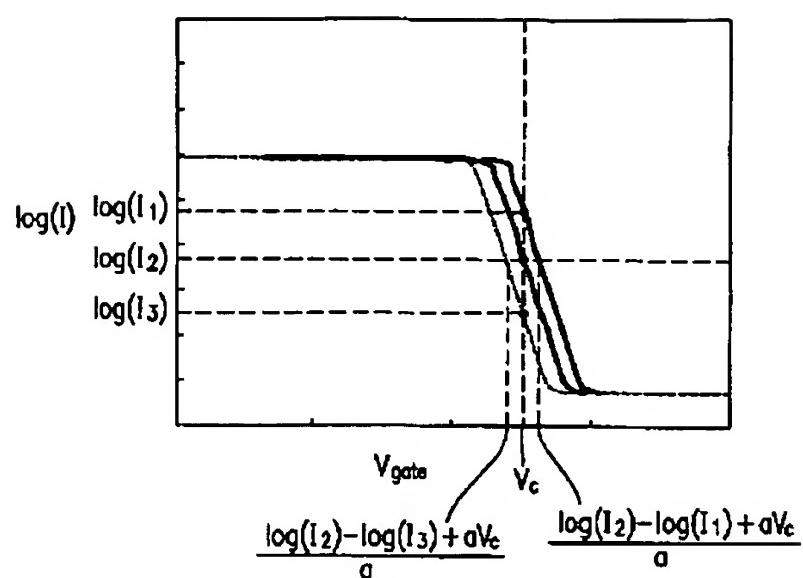
[Drawing 9]



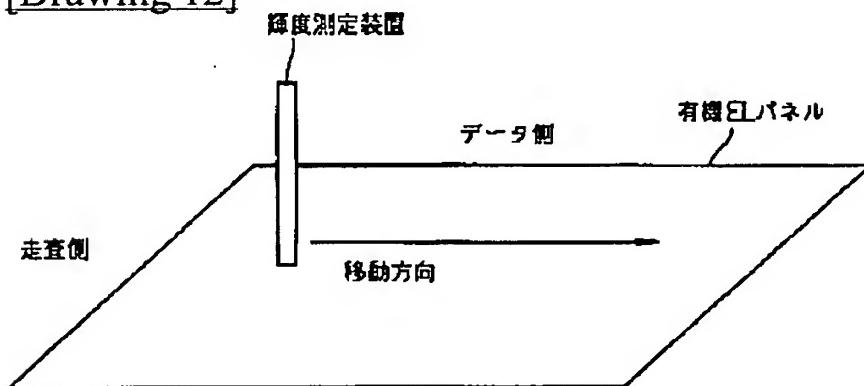
[Drawing 10]



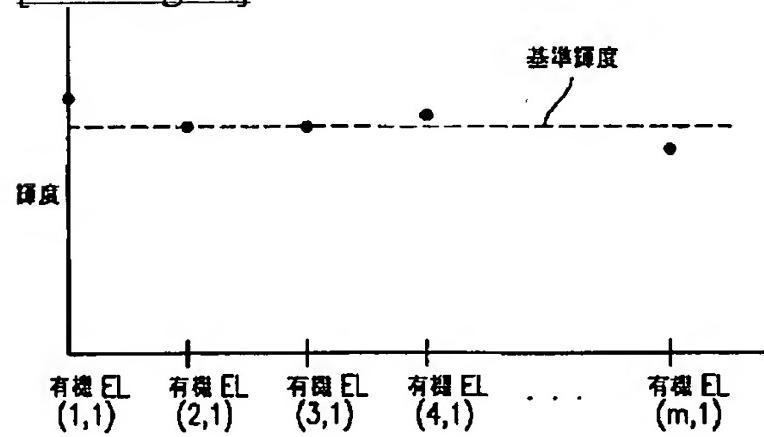
[Drawing 11]



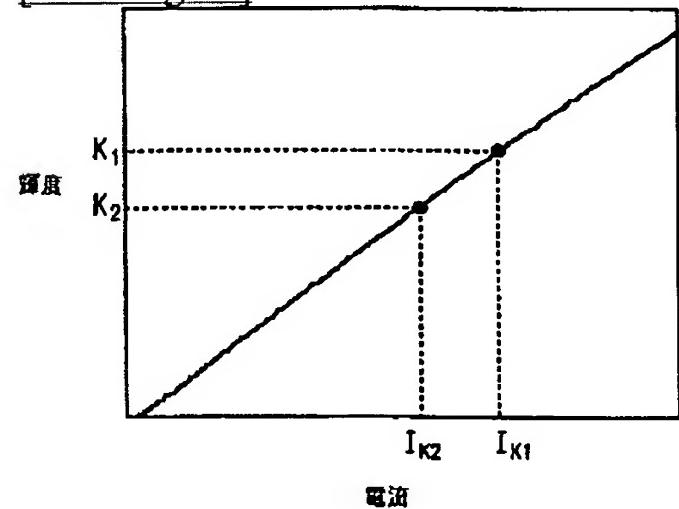
[Drawing 12]



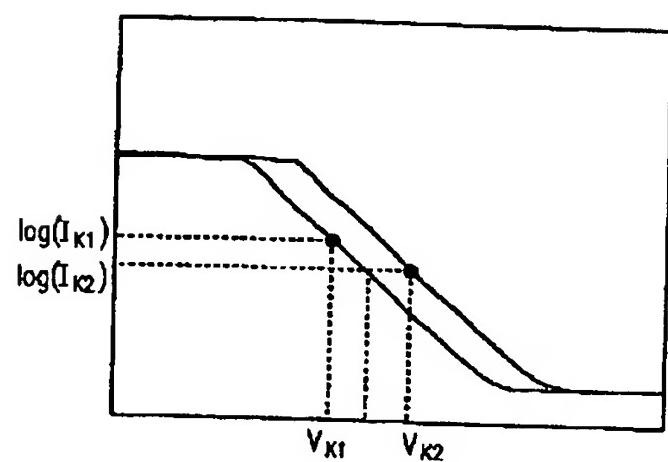
[Drawing 13]



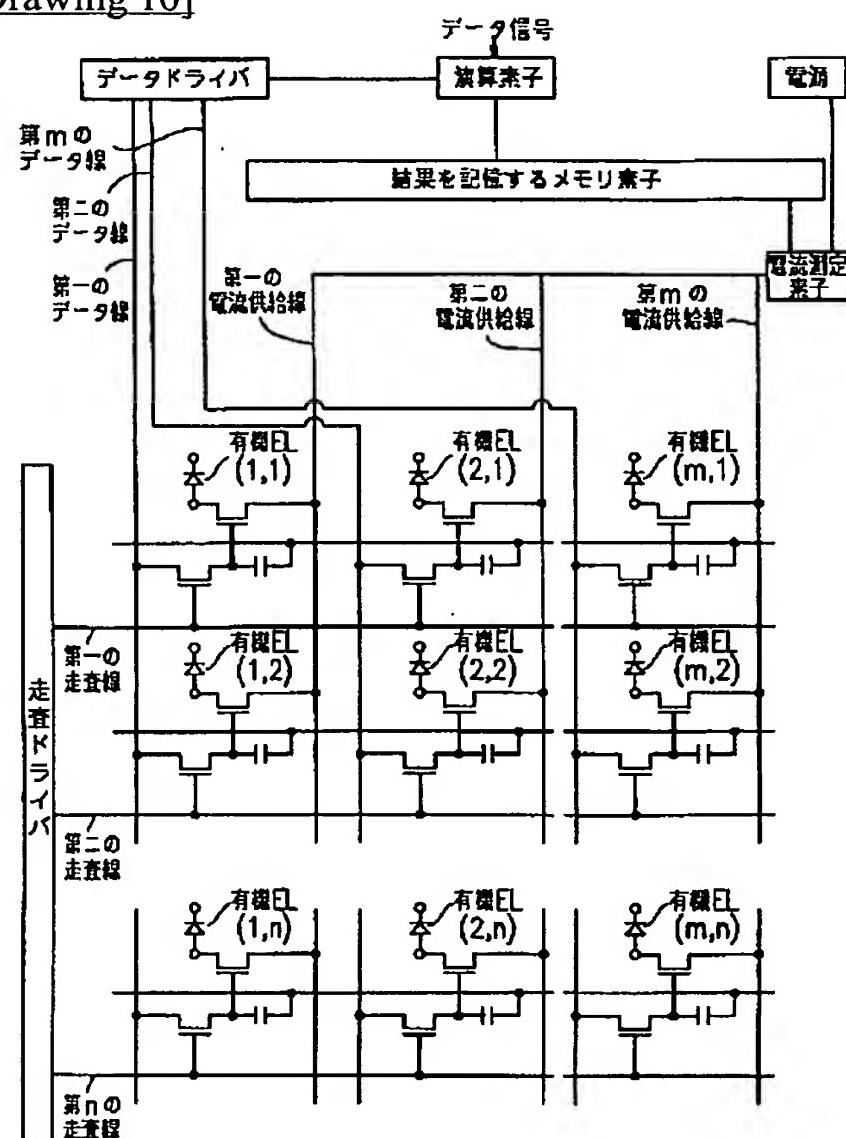
[Drawing 14]



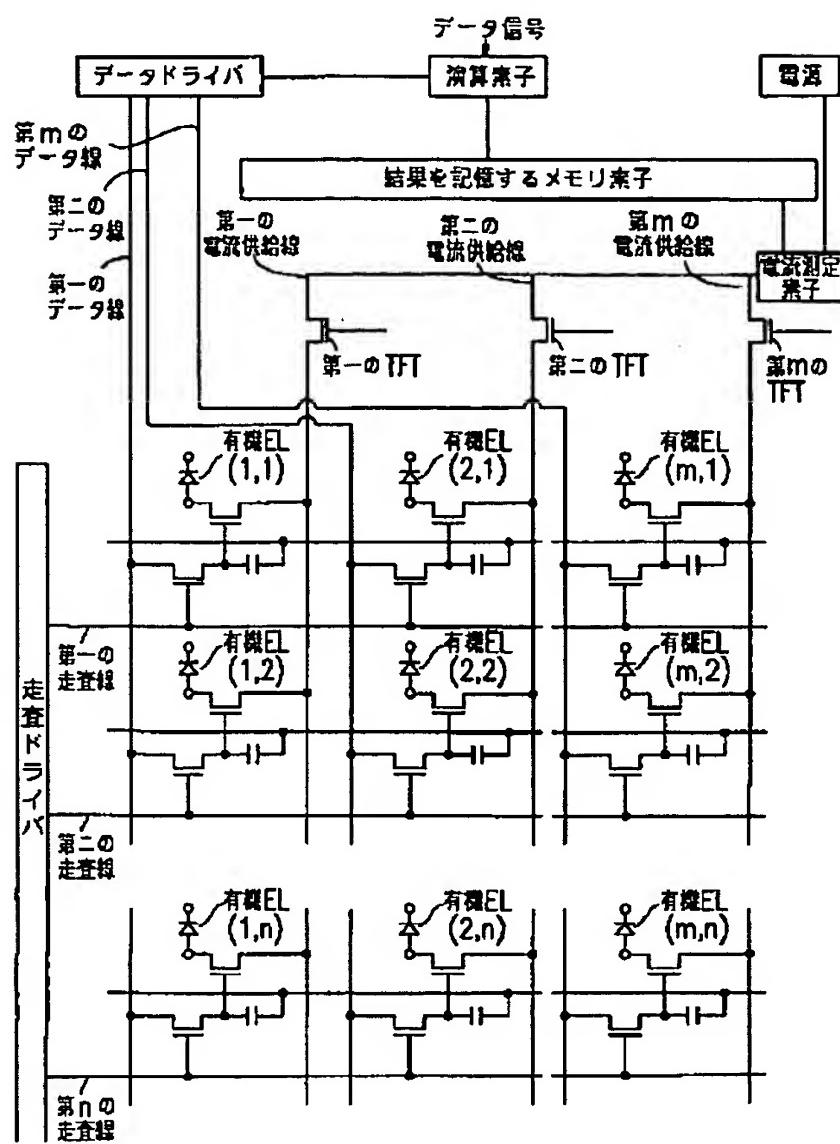
[Drawing 15]



[Drawing 16]



[Drawing 17]



[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2002-278513
(P2002-278513A)

(43)公開日 平成14年9月27日(2002.9.27)

(51)Int.Cl.⁷
G 0 9 G 3/30
3/20 6 1 1
6 2 3
6 4 2

識別記号

F I
G 0 9 G 3/30
3/20 6 1 1 H
6 2 3 R
6 4 2 A
6 4 2 P

テーマコード(参考)

J 5 C 0 8 0

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 12 頁)

(21)出願番号 特願2001-79599(P2001-79599)

(22)出願日 平成13年3月19日(2001.3.19)

(71)出願人 000005049
シャープ株式会社
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 加邊 正章
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

(72)発明者 沼尾 孝次
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

(74)代理人 100078282
弁理士 山本 秀策

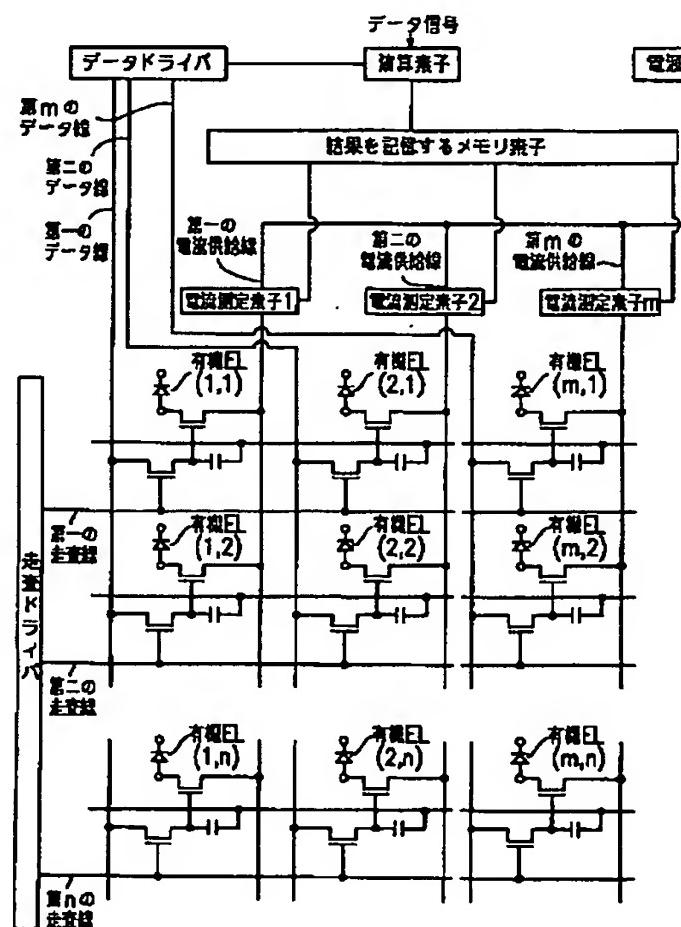
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 電気光学装置

(57)【要約】

【課題】 アクティブマトリクス構成において、各画素毎に電流測定素子を設けずに有機EL素子に流れる電流を測定し、TFT特性ばらつきによる輝度むらを補正する。

【解決手段】 アクティブ素子と有機EL素子がマトリクス状に配置され、有機EL素子に電流を供給する複数の電流供給線が配置され、各電流供給線毎に電流測定素子が設けられた電気光学装置において、1本の走査線に走査電圧を与え、それと同期して各データ線に所定のデータ電圧を供給し、電流測定素子により有機EL素子に流れる電流値を測定する。次に、同一の走査線に走査電圧を与え、それと同期して各データ線に電気光学素子を0階調にするデータ信号を供給する。この駆動動作を各走査線に対して行い、得られた電流測定値に基づいて各アクティブ素子に与えるデータ電圧を補正する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、アクティブ素子および該アクティブ素子によって制御される電気光学素子がマトリクス状に配置されていると共に、該アクティブ素子に走査電圧を与える走査線およびデータ電圧を与えるデータ線が該アクティブ素子の近傍を通って互いに交差するように配置され、さらに、該電気光学素子に該アクティブ素子を介して電流を供給するための複数の電流供給線が配置され、各電流供給線毎に電流を測定するための電流測定素子が設けられた電気光学装置において、

各電流測定素子によって、その電流測定素子が配置された電流供給線に接続された複数の電気光学素子の各々に流れる電流値を測定するべく、

1本の走査線に走査電圧を与え、そのタイミングと同期して、各データ線に所定のデータ電圧を供給し、該電流測定素子により該電気光学素子に流れる電流値を測定するステップと、同一の走査線に再度走査電圧を与え、そのタイミングと同期して、各データ線に該電気光学素子を0階調にするデータ信号を供給するステップとを各走査線に対して行って、得られた電流測定値に基づいて、各電気光学素子に流れる電流が等しくなるように、各アクティブ素子に与えるデータ電圧を補正することを特徴とする電気光学装置。

【請求項2】 さらに、前記電流供給線と交差する方向に前記電気光学素子の輝度値を測定し、得られた輝度測定値と前記電流測定値とに基づいて、各電気光学素子の輝度が等しくなるように、前記アクティブ素子に与えるデータ電圧を補正することを特徴とする請求項2に記載の電気光学装置。

【請求項3】 基板上に、アクティブ素子および該アクティブ素子によって制御される電気光学素子がマトリクス状に配置されていると共に、該アクティブ素子に走査電圧を与える走査線およびデータ電圧を与えるデータ線が該アクティブ素子の近傍を通って互いに交差するように配置され、さらに、該電気光学素子に該アクティブ素子を介して電流を供給するための複数の電流供給線が配置され、該電流供給線の電流を測定するために1つの電流測定素子が設けられた電気光学装置において、

該電流測定素子によって複数の電気光学素子の各々に流れる電流値を測定するべく、

1本の走査線に複数回走査電圧を与え、各回のタイミングと同期して、各々異なる1本のデータ線に所定のデータ電圧を供給し、その他のデータ線には該電気光学素子を0階調にするデータ信号を供給して、該電流測定素子により該電気光学素子に流れる電流値を測定するステップを各走査線に対して行って、得られた電流測定値に基づいて、各電気光学素子に流れる電流が等しくなるように、各アクティブ素子に与えるデータ電圧を補正することを特徴とする電気光学装置。

【請求項4】 基板上に、アクティブ素子および該アク

ティブ素子によって制御される電気光学素子がマトリクス状に配置されていると共に、該アクティブ素子に走査電圧を与える走査線およびデータ電圧を与えるデータ線が該アクティブ素子の近傍を通って互いに交差するように配置され、さらに、該電気光学素子に該アクティブ素子を介して電流を供給するための複数の電流供給線が配置され、該電流供給線の電流を測定するために1つの電流測定素子が設けられた電気光学装置において、各電流供給線毎に該電気光学素子よりも基板縁側にTFT

10 TFT素子が設けられ、該電流測定素子によって複数の電気光学素子の各々に流れる電流値を測定するべく、1本の走査線に走査電圧を与えると共に各データ線に所定のデータ電圧を供給し、各電流供給線毎に設けた前記TFT素子を順次走査することにより、該電流測定素子により該電気光学素子に流れる電流値を順次測定するステップを各走査線に対して行って、得られた電流測定値に基づいて、各電気光学素子に流れる電流が等しくなるように、各アクティブ素子に与えるデータ電圧を補正することを特徴とする電気光学装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、有機EL素子等の電気光学素子を用いた電気光学装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 有機EL素子は、他に光源を必要とせずに自ら発光する自発光素子であるため、これをディスプレイに応用した場合には、液晶を凌ぐ、高コントラストで広視野角が得られる薄型ディスプレイが得られる可能性を秘めている。

【0003】 図1は、一般的な有機EL素子の構造を示す概略断面図である。ここでは、基板上に陽極2、正孔注入層3、正孔輸送層4、発光層5、電子輸送層6および陰極7が順に積層されている。そして、両電極2、7に直流電圧を印加することにより、陽極2からホール(正孔)が、陰極7から電子が注入される。この2つの再結合によって、蛍光分子の1重項励起状態が生成され、その一重項励起分子が基底状態に戻る際に、外部に光を放出するという一連の過程により、有機EL素子の発光が得られるという原理である。

【0004】 図2(a)～図2(c)に、一般的な有機EL素子の特性を示す。図2(a)は印加電圧と輝度との関係を示し、図2(b)は印加電圧と電流との関係を示し、図2(c)は印加電圧と発光効率との関係を示す。輝度はある閾値電圧以上になると徐々に増加し、電流密度もある閾値電圧以上になると徐々に増加する。また、発光効率はある電圧において最大値となる。

【0005】 近年では、有機EL素子を用いた単純マトリクス構成およびアクティブマトリクス構成のディスプレイが盛んに開発されている。

【0006】図3に、一般的な単純マトリクス構成のディスプレイの回路構成を示す。ここでは、有機EL素子がマトリクス状に配置され、走査ドライバに接続された走査線とデータドライバに接続されたデータ線とが互いに交差（この例では直交）して設けられている。走査線は有機EL素子の陰極に接続され、データ線は有機EL素子の陽極に接続されている。

【0007】この単純マトリクス構成のディスプレイにおいては、各走査線を選択している期間のみ、それに接続された有機EL素子が発光する。このため、走査線の本数が増えてデューティー比が上がると、各走査線を選択している時間が短くなつて各画素の点灯時間が短くなり、その結果、ディスプレイの輝度減少を招く。これを回避するため、有機EL素子への印加電圧を増やして各画素の輝度を上げると、一般的に発光効率は高電圧になるほど下がるため、消費電力の増大を招く。

【0008】図4に、一般的なアクティブマトリクス構成のディスプレイの回路構成を示す。ここでは、マトリクス状に有機EL素子とそれを制御するアクティブ素子とが配置されている。図5に示すように、アクティブ素子には、nチャンネルTFTであるスイッチングTFTと、pチャンネルTFTであるドライビングTFTの2種類が必要である。また、このアクティブ素子に走査電圧（ゲートを開く信号）を与える走査線およびデータ電圧（データ信号）を与えるデータ線が互いに交差（この例では直交）して設けられ、各々走査ドライバおよびデータドライバに接続されている。さらに、有機EL素子にアクティブ素子を介して電流を供給するための電流供給線がデータ線に平行に設けられている。

【0009】このアクティブマトリクス構成のディスプレイにおいては、走査線からスイッチングTFTのゲート信号が入力され、これと同期してデータ線からデータ信号に応じた量の電荷がキャパシタに入力される。このキャパシタに蓄積された電荷量に応じてドライビングTFTのソース・ドレン間の抵抗値が決定され、電流供給線から有機EL素子に電流が供給されて有機EL素子が発光する。そして、スイッチングTFTが閉じられた後も、ドライビングTFTを通して電流供給線から有機EL素子に電流供給されるため、次の走査まで、有機EL素子を発光させることが可能となる。このため、デューティー比が上がってもディスプレイの輝度減少を招くようなことはなく、低電圧で駆動できるため、低消費電力化が可能となる。また、この構成の場合、データ線からのデータ信号に応じてソース・ドレン間の抵抗値が決まり、これにより有機EL素子に供給される電流量が決まるため、データ信号に応じた輝度が得られ、階調表示を行うことも可能である。

【0010】このように、アクティブマトリクス構成のディスプレイでは、単純マトリクス構成に比べて低消費電力化を図ることができるため、好ましい。しかしながら

ら、アクティブマトリクス構成では、ドライビングTFTの特性ばらつきのため、各画素において有機EL素子に流れる電流量が異なり、輝度むらが発生するという欠点があった。

【0011】これを回避するために、例えば特開平11-282420号公報では、予め表示データをEL表示パネルに入力して全画面を点灯させ、そのときの各画素の輝度を測定し、この測定値の平均値を算出してその差分をさらに算出し、その差分を補正值として補正情報メモリに記憶させる。そして、その補正值を表示データ（データ信号）に加算器にて加算し、EL表示パネルに入力することにより、表示ばらつきを補正している。これにより、TFTの特性ばらつきによるEL素子の輝度むらを補正することができる。

【0012】また、有機EL素子は発光時間と共に劣化し、発光輝度が減少していくという問題もあった。一般的に各画素毎の発光頻度は異なるため、発光頻度の多い画素は次第に暗くなり、発光頻度の少ない画素は変化が少ないので、輝度むらが発生する。

【0013】これを回避するために、例えば特開平10-254410号公報では、各有機EL素子を所定の電圧値で駆動したとき、有機EL素子に流れる電流値を計測し、この電流値をメモリに記憶させる。そして、その電流値に基づいてデータ信号を演算し、1フレーム期間内における発光時間を決めている。これにより、有機EL素子の劣化による輝度むらを補正することができる。

【0014】さらに、特開2000-187467号公報では、点灯中の有機EL素子の各画素に流れる電流を検出する電流検出手段を設けて、検出した電流に応じて画素の点灯時間または点灯電流を制御している。これにより、素子のばらつきや劣化による輝度変化を検出することができ、良好な階調制御を行うことができる。

【0015】

【発明が解決しようとする課題】単純マトリクス構成の場合、上述したような駆動方法のため、各走査線上の画素毎に順次発光し、走査が終了した走査線上の各有機EL素子には電流が流れず、発光しない。このため、特開2000-187467号公報のように各データ線毎に電流測定素子が存在すれば、各有機EL素子に流れる電流を検出することができる。

【0016】しかし、この技術をアクティブマトリクス構成に適用するのは、従来では不可能であった。その理由は、スイッチングTFTの走査が終了した後も、ドライビングTFTを通して有機EL素子に電流が供給されるため、各電流供給線毎に電流測定素子を設けた場合、その電流供給線に接続された全ての有機EL素子に流れる電流値の総和を測定してしまうからである。

【0017】このため、各画素の有機EL素子に流れる電流を測定しようとした場合、特開平10-254410号公報のように、各画素毎に電流測定素子を配置する

必要があった。しかし、各画素毎に電流測定素子を配置すると、開口率の低下を招き、また、各画素の回路構成も複雑になるため、製造歩留まり減少の要因となる。さらに、各画素毎の電流測定素子自体にも特性ばらつきがあるため、正確な電流検出は不可能である。

【0018】本発明は、このような従来技術の課題を解決するべくなされたものであり、アクティプマトリクス構成において、各画素毎に電流測定素子を設けなくても、有機EL素子や無機EL素子等の電気光学素子に流れる電流を測定することができ、TFT特性のばらつきによる輝度むらを補正できる電気光学装置を提供することを目的とする。

【0019】

【課題を解決するための手段】本発明の電気光学装置は、基板上に、アクティプ素子および該アクティプ素子によって制御される電気光学素子がマトリクス状に配置されていると共に、該アクティプ素子に走査電圧を与える走査線およびデータ電圧を与えるデータ線が該アクティプ素子の近傍を通って互いに交差するように配置され、さらに、該電気光学素子に該アクティプ素子を介して電流を供給するための複数の電流供給線が配置され、各電流供給線毎に電流を測定するための電流測定素子が設けられた電気光学装置において、各電流測定素子によって、その電流測定素子が配置された電流供給線に接続された複数の電気光学素子の各々に流れる電流値を測定するべく、1本の走査線に走査電圧を与え、そのタイミングと同期して、各データ線に所定のデータ電圧を供給し、該電流測定素子により該電気光学素子に流れる電流値を測定するステップと、同一の走査線に再度走査電圧を与え、そのタイミングと同期して、各データ線に該電気光学素子を0階調にするデータ信号を供給するステップとを各走査線に対して行って、得られた電流測定値に基づいて、各電気光学素子に流れる電流が等しくなるように、各アクティプ素子に与えるデータ電圧を補正し、そのことにより上記目的が達成される。

【0020】上記構成によれば、後述する実施形態1に示すように、電流測定素子が各電流供給線毎に設けられている構成において、各電気光学素子に流れる電流値を測定してデータ電圧(データ信号)を補正することが可能である。

【0021】さらに、前記電流供給線と交差する方向に前記電気光学素子の輝度値を測定し、得られた輝度測定値と前記電流測定値とに基づいて、各電気光学素子の輝度が等しくなるように、前記アクティプ素子に与えるデータ電圧を補正してもよい。

【0022】上記構成によれば、後述する実施形態2に示すように、電流測定素子自体にばらつきがあっても、電気光学素子の発光輝度にばらつきが生じるのを防ぐことが可能である。

【0023】本発明の電気光学装置は、基板上に、アク

ティブ素子および該アクティブ素子によって制御される電気光学素子がマトリクス状に配置されていると共に、該アクティブ素子に走査電圧を与える走査線およびデータ電圧を与えるデータ線が該アクティブ素子の近傍を通って互いに交差するように配置され、さらに、該電気光学素子に該アクティブ素子を介して電流を供給するための複数の電流供給線が配置され、該電流供給線の電流を測定するために1つの電流測定素子が設けられた電気光学装置において、該電流測定素子によって複数の電気光学素子の各々に流れる電流値を測定するべく、1本の走査線に複数回走査電圧を与え、各回のタイミングと同期して、各々異なる1本のデータ線に所定のデータ電圧を供給し、その他のデータ線には該電気光学素子を0階調にするデータ信号を供給して、該電流測定素子により該電気光学素子に流れる電流値を測定するステップを各走査線に対して行って、得られた電流測定値に基づいて、各電気光学素子に流れる電流が等しくなるように、各アクティブ素子に与えるデータ電圧を補正し、そのことにより上記目的が達成される。

【0024】上記構成によれば、後述する実施形態3に示すように、1つの電流測定素子により各電気光学素子に流れる電流値を測定してデータ電圧(データ信号)を補正することが可能である。

【0025】本発明の電気光学装置は、基板上に、アクティブ素子および該アクティブ素子によって制御される電気光学素子がマトリクス状に配置されていると共に、該アクティブ素子に走査電圧を与える走査線およびデータ電圧を与えるデータ線が該アクティブ素子の近傍を通って互いに交差するように配置され、さらに、該電気光学素子に該アクティブ素子を介して電流を供給するための複数の電流供給線が配置され、該電流供給線の電流を測定するために1つの電流測定素子が設けられた電気光学装置において、各電流供給線毎に該電気光学素子よりも基板縁側にTFT素子が設けられ、該電流測定素子によって複数の電気光学素子の各々に流れる電流値を測定するべく、1本の走査線に走査電圧を与えると共に各データ線に所定のデータ電圧を供給し、各電流供給線毎に設けた前記TFT素子を順次走査することにより、該電流測定素子により該電気光学素子に流れる電流値を順次

測定するステップを各走査線に対して行って、得られた電流測定値に基づいて、各電気光学素子に流れる電流が等しくなるように、各アクティブ素子に与えるデータ電圧を補正し、そのことにより上記目的が達成される。

【0026】上記構成によれば、後述する実施形態4に示すように、1つの電流測定素子により各電気光学素子に流れる電流値を測定してデータ電圧(データ信号)を補正することが可能となる。

【0027】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

【0028】(実施形態1) 図6は、本発明の電気光学装置の一実施形態である有機ELパネルの構成を説明するための回路図である。この有機ELパネルは、基板上に、アクティブ素子とそれによって制御される有機EL素子がマトリクス状に配置されている。有機EL素子は、図1に示したように、基板1上に陽極2、正孔注入層3、正孔輸送層4、発光層5、電子輸送層6および陰極7を順に積層して構成されている。また、アクティブ素子は、図5に示したように、スイッチングTFT、ドライビングTFTおよびキャパシタから構成されている。また、アクティブ素子に走査電圧を与える走査線およびデータ電圧を与えるデータ線がアクティブ素子の近傍を通って互いに交差するように配置されている。走査線は走査ドライバに接続され、データ線はデータドライバに接続されている。さらに、電気光学素子にアクティブ素子を介して電流を供給するための複数の電流供給線が配置されている。

【0029】さらに、本実施形態では、各電流供給線毎に電流を測定するための電流測定素子が設けられている。この電流測定素子としては、例えば図18に示すような構成のものを用いることができる。電流測定素子には、電流測定結果を記憶するためのメモリ素子が接続され、メモリ素子は、演算素子を介してデータドライバに接続されている。

【0030】次に、このように構成された有機ELパネルにおいて、TFT特性のばらつきによる有機EL素子の輝度むらを補正する方法について説明する。まず、各有機EL素子に流れる電流値を測定する方法について説明する。まず、第一の走査線に走査電圧を与えて、第一の走査線上のスイッチングTFTのゲートをオープンにする。これと同期して、各データ線を通して所定のデータ電圧(例えば、電流-輝度特性において輝度を等分割した場合に相当する電流を実現するための電圧)を入力する。これにより、ドライビングTFTのゲートがキャパシタに蓄積された電荷量に応じてオープンされ、電流供給線から第一の走査線上の有機EL素子に電流が流れ込む。このときのドライビングTFTのゲート電圧はデータ電圧とほぼ等しく、それに応じた電流が有機EL素子に流れる。このときに各有機EL素子に流れる電流量を電流測定素子によって測定し、測定結果をメモリ素子に記憶させる。その後、再び第一の走査線に走査電圧を与えて、第一の走査線上のスイッチングTFTのゲートをオープンにする。これと同期して、各データ線を通して、有機EL素子を0階調とするデータ電圧を入力する。これにより、第一の走査線上の有機EL素子に電流が流れなくなる。

【0031】以上の走査を順次、他の走査線についても行っていく。これにより、各有機EL素子に流れる電流値を全て測定することが可能になる。

【0032】例えば、第一のデータ線上の各有機EL素子(有機EL(1,1)、有機EL(1,2)、…、有機EL(1,n))に流れる電流量は、電流測定素子1により測定される。この電流量は、縦軸に $\log(I)$ (Iは電流量)をとると、図7に示すようにはらつきがある。これは、ドライビングTFTの特性ばらつきによるものである。このように各有機EL素子に流れる電流量が異なると、得られる輝度も異なり、輝度むらが発生する。

【0033】次に、この電流値ばらつきを補正して、均一な輝度を得る方法について説明する。一般的なTFTにおいて、ゲート電圧： V_{gate} と流れる電流値： $\log(I)$ の関係は、図8に示すようになる。この図8において、傾いている部分は、

【0034】

【数1】

$$\log(I) = aV_{gate} + b \quad (a \text{ は傾き}, b \text{ は切片}) \dots (1)$$

【0035】で表される直線により定義することができる。

【0036】TFT素子の特性が異なると、図9に示すように、特性に差異が生じる。このため、同一のゲート電圧を入力しても、流れる電流値にばらつきが生じるのである。但し、各TFTにおいて、上記式(1)のaについてはほとんど変わらない。また、図6に示したような回路構成においては、ゲート電圧はデータ信号(データ電圧)に等しいと考えられる。

【0037】ここで、説明を簡単にするために、図6における有機EL(1,1)、有機EL(1,2)および有機EL(1,3)の3つの有機EL素子に流れる電流値(図7)のみを考え、これを基にして輝度を補正する方法を考える。これらは、同一のデータ電圧、すなわち、同一のゲート電圧(以下、 V_c とする)をドライビングTFTに与えたときに流れた電流値であり、各々 $\log(I_1)$ 、 $\log(I_2)$ および $\log(I_3)$ とする。これを横軸：ゲート電圧(V_{gate})、縦軸：電流量 $\log(I)$ としてグラフにプロットすると、図10に示すようになる。TFTの電流特性は、図8に示したように分かっているので、図10の各点を通過するようになると、図11に示すようになる。このとき、傾いている部分の直線は、

【0038】

【数2】

9

$$\text{有機EL(1,1) では、 } \log(I) = aV_{gate} + (\log(I_1) - aV_c) \quad \dots (2)$$

$$\text{有機EL(1,2) では、 } \log(I) = aV_{gate} + (\log(I_2) - aV_c) \quad \dots (3)$$

$$\text{有機EL(1,3) では、 } \log(I) = aV_{gate} + (\log(I_3) - aV_c) \quad \dots (4)$$

10

【0039】のように表される。

【0040】ここで、図7に示すように、基準の電流値を有機EL(1,2)に流れる電流と決めて、有機EL(1,1)および有機EL(1,3)においても有機EL(1,2)と同一の電流値が流れるゲート電圧を上記式(2)および上記式(4)から求めると、

【0041】

【数3】

$$\text{有機EL(1,1) では、 } \frac{\log(I_2) - \log(I_1) + aV_c}{a}$$

$$\text{有機EL(1,3) では、 } \frac{\log(I_2) - \log(I_3) + aV_c}{a}$$

【0042】となる。このゲート電圧を各々有機EL(1,1)および有機EL(1,3)のドライビングTFTに入力すれば、有機EL(1,2)と同一の電流が流れ、均一な輝度が得られる。なお、aは素子間のばらつきが少ないため、いずれか一つのTFTで予め測定しておくことができる。

【0043】このように同一のデータ電圧(ゲート電圧)をドライビングTFTに与えた場合に、流れる電流値が異なる場合でも、簡単な演算によりデータ電圧を補正することにより、有機EL素子に同一の電流を流して、均一な輝度を得られるようになることができる。

【0044】他のデータ電圧(ドライビングTFTのゲート電圧)の補正においては、上記電流測定を再び行ってよいが、上記式(2)～上記式(4)を利用して、計算により求めることもできる。例えば、有機EL(1,2)において、ゲート電圧 V_c' のとき、流れる電流は

【0045】

【数4】

$$aV_c' + (\log(I_2) - aV_c)$$

【0046】で表される。有機EL(1,1)および有機EL(1,3)において、有機EL(1,2)と同一の電流値が流れるゲート電圧を上記式(1)および上記式(3)から求めると、

【0047】

【数5】

$$\text{有機EL(1,1) では、 } \frac{\log(I_2) - \log(I_1) + aV_c}{a}$$

$$\text{有機EL(1,3) では、 } \frac{\log(I_2) - \log(I_3) + aV_c}{a}$$

【0048】となる。このゲート電圧を各々有機EL(1,1)および有機EL(1,3)のドライビングTFTに入力すれば、有機EL(1,2)と同一の電流が流れ、均一な輝度が得られる。このように、一旦あるデータ電圧で電流測定を行っておけば、他のデータ電圧における補正も、この電流値に基づいて行うことができる。

【0049】第一の走査線上的他の有機EL素子、および他の走査線上的有機EL素子においても、簡単な演算により同一の電流が流れるデータ電圧(ドライビングTFTのゲート電圧)を決定することができ、これによって均一な輝度を得ることができる。

【0050】上記電流測定素子により得られた電流測定結果は、図6に示した結果を記憶するメモリ素子に記憶され、演算素子によりデータ信号の補正が行われ、補正されたデータ信号がデータドライバに送られる。以上の過程により、均一な階調表示を行うことができる。なお、上述のような輝度補正是、ユーザが使用前や使用中に適宜行うことができる。

【0051】(実施形態2) 上記実施形態1において、データ線に沿った方向の有機EL素子の輝度補正是、各電流測定素子によって測定される電流値によって行われる。よって、各電流測定素子自体にばらつきが無い場合には、実施形態1で説明した方法により、全ての有機ELにおいて均一な輝度を得ることができる。

【0052】しかし、電流測定素子が基板に作り込まれている場合には、電流測定素子自体に特性ばらつきがあり、測定自体にばらつきが生じているおそれがある。この場合、実施形態1のようにデータ電圧を補正しても、走査線に沿った方向(電流供給線を横切る方向)において、有機EL素子の輝度が異なる。例えば、有機EL(1,1)、有機EL(2,1)、…、有機EL(m,1)において、輝度が同一となるようにデータ電圧を入力しても輝度が異なることになる。

【0053】この電流測定素子自体の特性ばらつきを補正するためには、実施形態1のような補正を行って補正された所定のデータ電圧を入力した後、図12に示すように、走査線に沿った方向に対して画素の輝度測定を行う。この輝度測定によって、有機EL(1,1)、有機EL(2,1)、…、有機EL(m,1)の輝度が例えば図13に示すようになった場合を考える。

【0054】以下では、説明の簡略化のために、有機EL(1,1)および有機EL(2,1)について考える。有機ELの電流-輝度特性は、図14に示すように、ほぼ直線で近似することができる。ここで、有機EL

50

L(1, 1)の輝度をK₁、有機EL(2, 1)の輝度K₂とし、そのときの電流値をI_{K1}、I_{K2}とする。また、この輝度における有機EL(1, 1)のドライビングTFTのゲート電圧をV_{K1}、有機EL(2, 1)のドライビングTFTのゲート電圧をV_{K2}とする。この場合、ゲート電圧と有機ELに流れる電流の関係は図15に示したようなものになる。

【0055】よって、有機EL(1, 1)の輝度レベルを基準輝度として、上記実施形態1と同様の考え方により、有機EL(1, 1)のドライビングTFTのゲート電圧を

【0056】

【数6】

$$\frac{\log(I_{K2}) - \log(I_{K1}) + aV_{K1}}{a}$$

【0057】にすれば、有機EL(1, 1)および有機EL(2, 1)に流れる電流値が一致し、輝度と同じにすることができる。第一のデータ線上の他の有機EL素子においても、上記と同様に補正を行うことにより、第二のデータ線上の有機EL素子と同一の輝度が得られる。

【0058】このように、電流測定素子自体に特性ばらつきがあり、走査線に沿った方向において有機EL素子の発光輝度にばらつきが生じている場合にも、以上のように補正を行うことにより、均一な輝度を得ることができる。

【0059】(実施形態3) 本実施形態では、図16に示すように、1つの電流測定素子により各有機EL素子に流れる電流を測定する例について説明する。この場合、実施形態1のように、走査線の走査と同期して、全てのデータ線に所定の電圧を与えたのでは、各々の有機EL素子に流れる電流を測定することができない。そこで、本実施形態では、以下のような手順により有機EL素子に流れる電流を測定する。

【0060】まず、第一の走査線に走査電圧を与えて、第一の走査線上のスイッチングTFTのゲートをオープンにする。これと同期して、第一のデータ線に所定のデータ電圧を入力し、それ以外のデータ線には有機EL素子を0階調とするデータ電圧を入力する。これにより、有機EL(1, 1)に流れる電流を電流測定素子により測定することができる。その後、再び第一の走査線に走査電圧を与えて、第一の走査線上のスイッチングTFTのゲートをオープンにする。これと同期して、第二のデータ線に所定のデータ電圧を入力し、それ以外のデータ線には有機EL素子を0階調とするデータ電圧を入力する。これにより、有機EL(1, 2)に流れる電流を電流測定素子により測定することができる。以上の処理を順次、他のデータ線について繰り返すことにより、第一の走査線上の各有機EL素子に流れる電流を1つの電流測定素子により測定することができる。他の走査線上

の各有機EL素子に流れる電流を測定する際には、以上の処理を順次、他の走査線について行えばよい。これにより、各有機EL素子に流れる電流値を全て測定することが可能になる。

【0061】このようにして得られた各有機EL素子に流れる電流値をメモリに保存し、これに基づいて上記実施形態1に示したようにデータ電圧を補正することにより、均一な階調表示を得ることができる。

【0062】(実施形態4) 本実施形態では、図17に示すように、1つの電流測定素子により各有機EL素子に流れる電流を測定する他の例について説明する。ここでは、各電流供給線毎にTFT素子が配置されている。この場合の電流測定方法について、以下に説明する。

【0063】初期状態においては、各電流供給線に配置されたTFT素子のゲートは閉じられている。その状態において、まず、第一の走査線に走査電圧を与えて、第一の走査線上のスイッチングTFTのゲートをオープンにし、これと同期して、第一のデータ線に所定のデータ電圧を入力する。これにより、第一の走査線上のドライビングTFTのゲートはオープンになるが、各電流供給線に配置されたTFTのゲートが全て閉じられているため、第一の走査線上の有機EL素子には電流が流れない。次に、第一の電流供給線に配置されたTFTのゲートをオープンにする。これにより、有機EL素子(1, 1)のみに電流が流れる。このときの電流を電流測定素子により測定する。この後、順次第二の電流供給線に配置されたTFT、第三の電流供給線に配置されたTFT、・・・とゲートをオープンにし、このときに各有機EL素子に流れる電流を測定することにより、第一の走査線上の各有機EL素子に流れる電流値を1つの電流測定素子により測定することができる。この後、再び第一の走査線を走査して、各データ線を通して有機EL素子が0階調となるデータ電圧を入力する。そして、第二の走査線、第三の走査線、・・・と順次以上の処理を繰り返すことにより各有機EL素子に流れる電流値を全て測定することができる。

【0064】このようにして得られた各有機EL素子に流れる電流値をメモリに保存し、これに基づいて上記実施形態1に示したようにデータ電圧を補正することにより、均一な階調表示を得ることができる。

【0065】なお、上記実施形態では、電気光学光学素子として有機EL素子を用いた電気光学装置の例について説明したが、本発明は、無機EL素子を用いた電気光学装置に対しても適用可能である。

【0066】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、アクティブマトリクス構成の有機EL素子において、各電流供給線毎に電流測定素子を設けた場合でも、各有機EL素子に流れる電流を測定し、この電流値を用いて輝度ばらつきを補正することができる。さらに、電流測定

素子を1つだけ設けた場合でも、各有機EL素子に流れ る電流を測定し、この電流値を用いて輝度ばらつきを補 正することができる。従って、各画素毎に電流測定素子 を配置する必要があった従来技術に比べて、開口率を向 上し、回路構成を簡略化して歩留まりを向上させること ができる。さらに、電流測定素子の特性ばらつきによる 電流測定ばらつきを防いで正確に電流検出を行うこと ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】一般的な有機EL素子の構造を示す概略断面図 である。

【図2】有機EL素子の特性を示すグラフであり、 (a) は印加電圧と輝度との関係を示し、 (b) は印加 電圧と電流との関係を示し、 (c) は印加電圧と発光効 率との関係を示す。

【図3】一般的な単純マトリクス構成の有機ELパネル の構成を示す回路図である。

【図4】一般的なアクティブマトリクス構成の有機EL パネルの構成を示す回路図である。

【図5】一般的なアクティブマトリクス構成の有機EL パネルの基本単位を示す詳細図である。

【図6】実施形態1の有機ELパネルの構成を示す回路 図である。

【図7】実施形態1において、電流測定素子により測定 された、各有機EL素子に流れる電流量を示すグラフで ある。

【図8】一般的なTFTにおけるゲート電圧と電流量の 関係を示すグラフである。

【図9】一般的なTFTにおいて、素子特性がばらつい

た場合のゲート電圧と電流量の関係を示すグラフであ る。

【図10】図6に示した有機EL(1、1)、有機EL(1、2) および有機EL(1、3)のゲート電圧 V_G における電流量を示すグラフである。

【図11】図6に示した有機EL(1、1)、有機EL(1、2) および有機EL(1、3)のドライビングTFTの特性を示すグラフである。

【図12】輝度測定の方法を説明するための図である。

【図13】走査線方向に沿った方向の有機ELの輝度ば らつきを示すグラフである。

【図14】有機ELの電流-輝度特性を示すグラフである。

【図15】図6に示した有機EL(1、1)、(2、 1)のドライビングTFTの特性を示すグラフである。

【図16】実施形態2の有機ELパネルの構成を示す回 路図である。

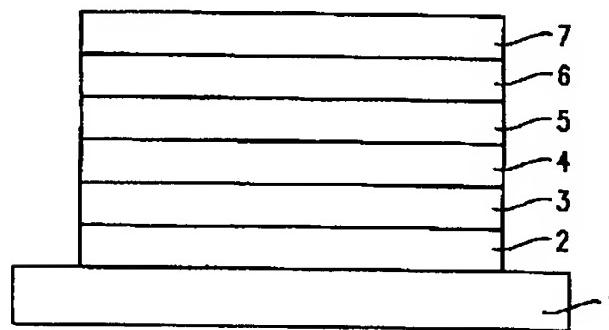
【図17】実施形態3の有機ELパネルの構成を示す回 路図である。

【図18】実施形態で用いる電流測定素子の構成の一例 を示す図である。

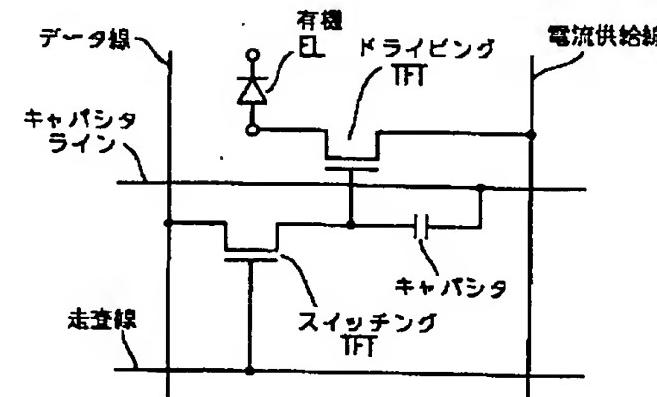
【符号の説明】

- 1 基板
- 2 陽極
- 3 正孔注入層
- 4 正孔輸送層
- 5 発光層
- 6 電子輸送層
- 7 陰極

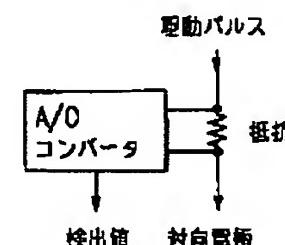
【図1】



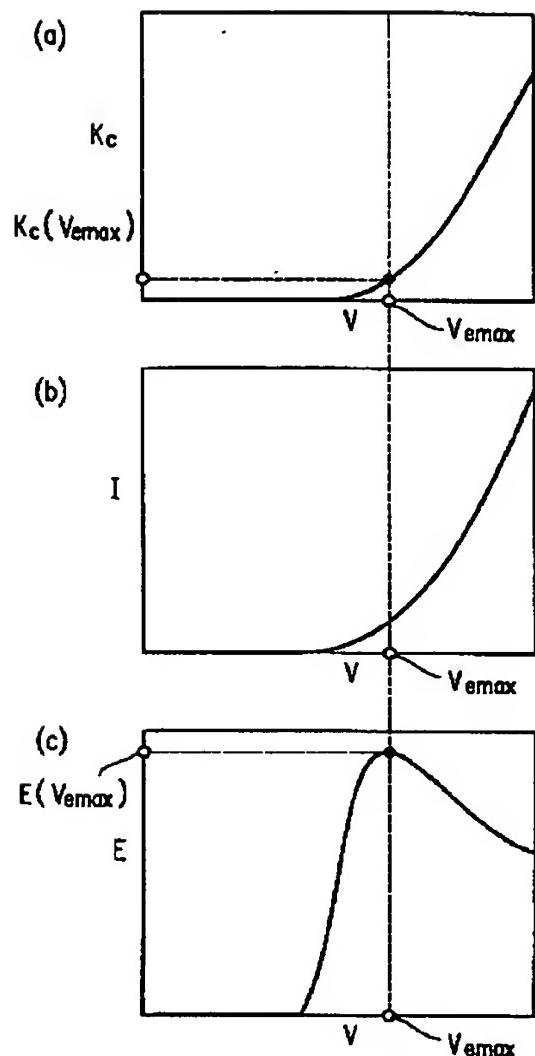
【図5】



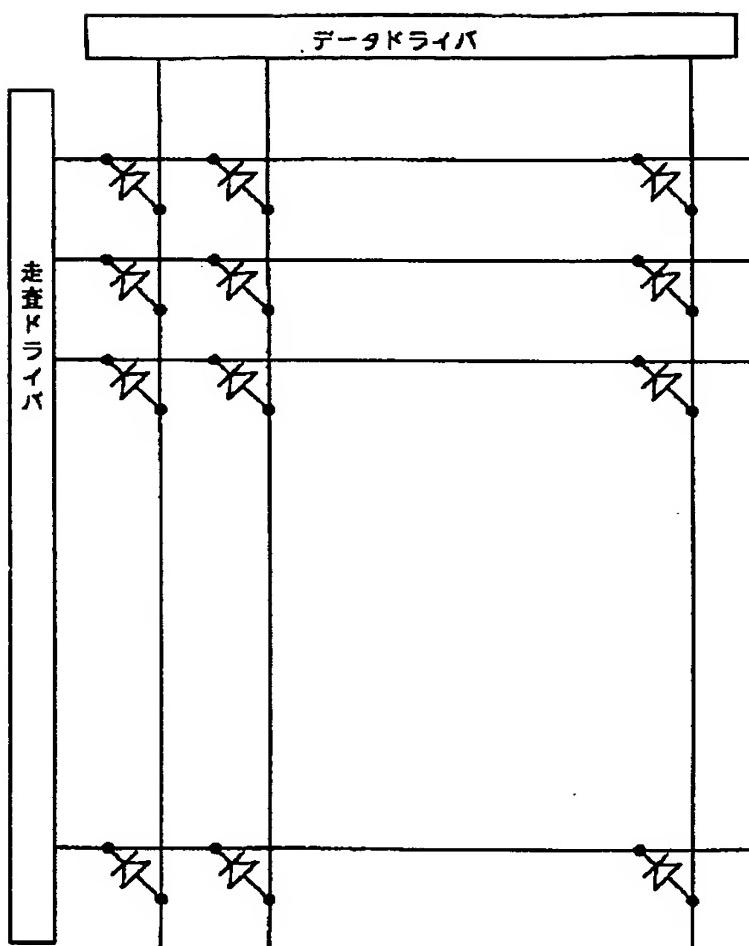
【図18】



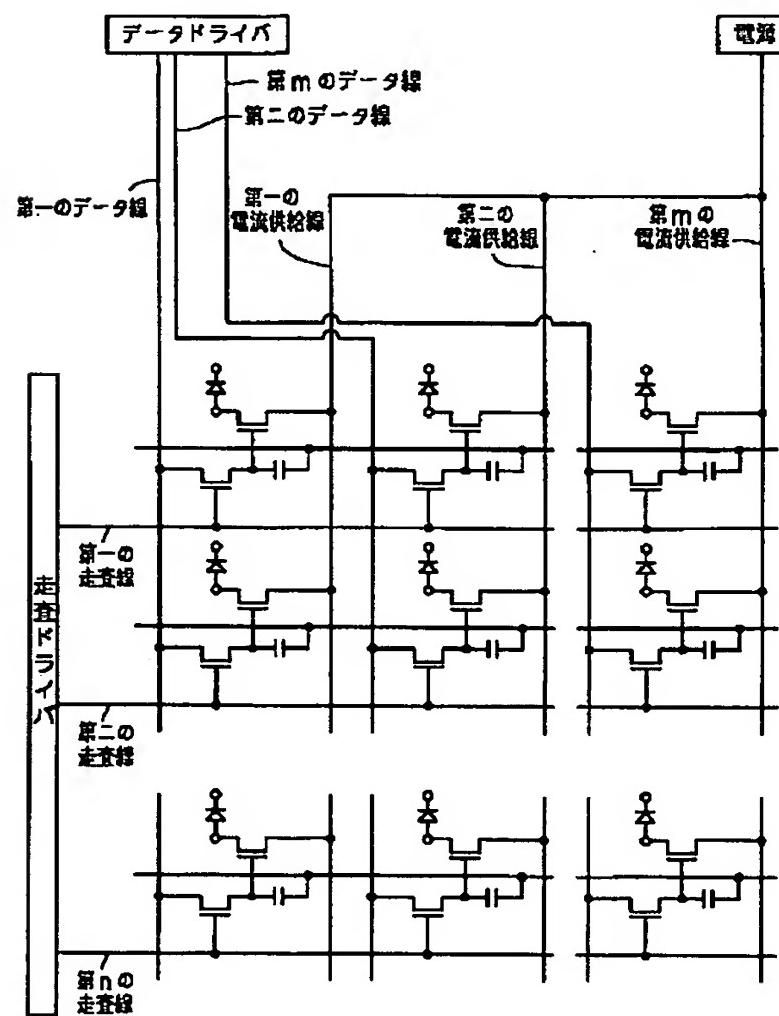
【図2】



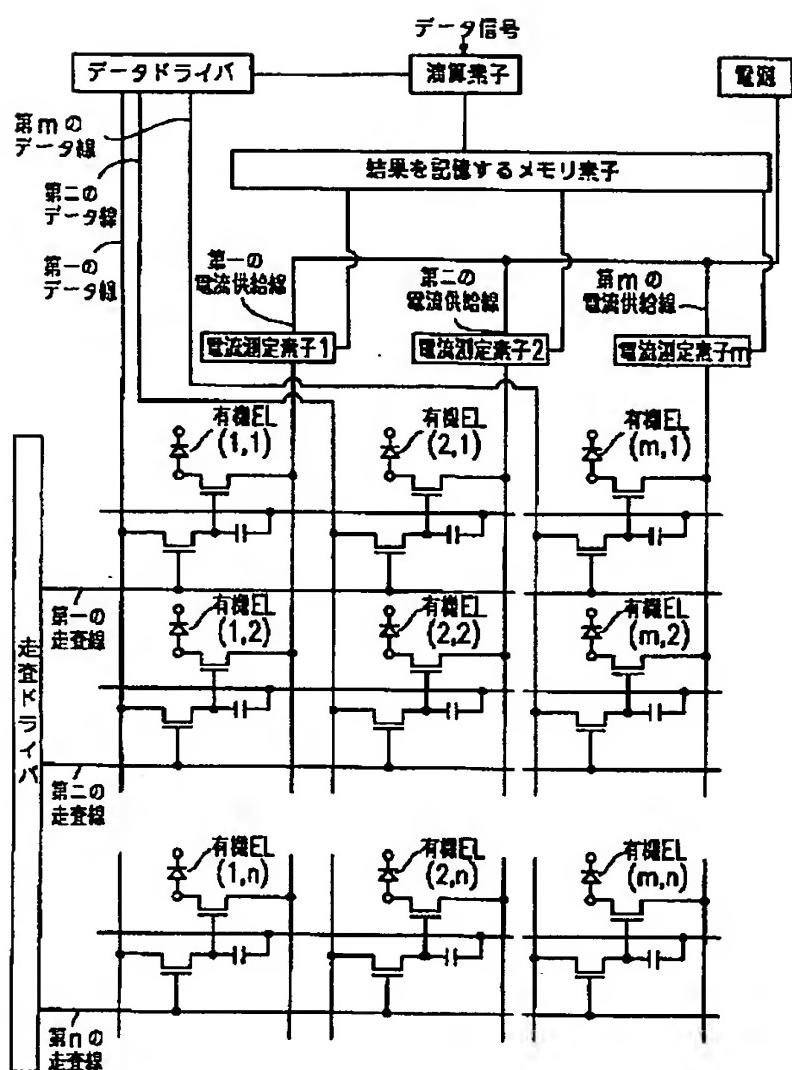
【図3】



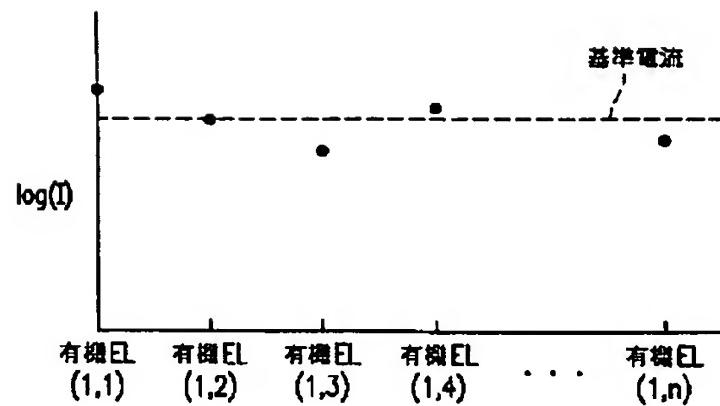
【図4】



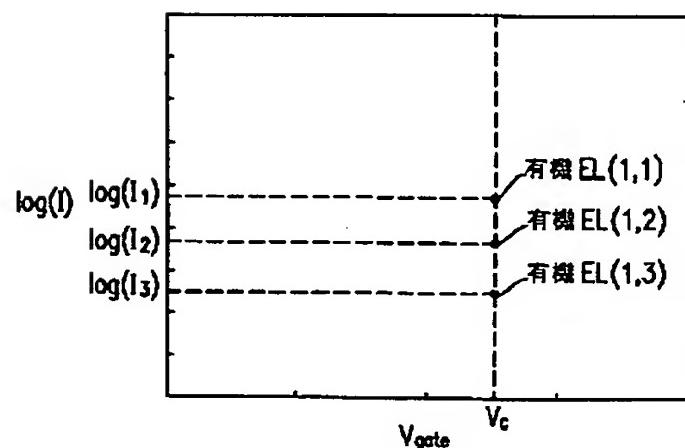
【図6】



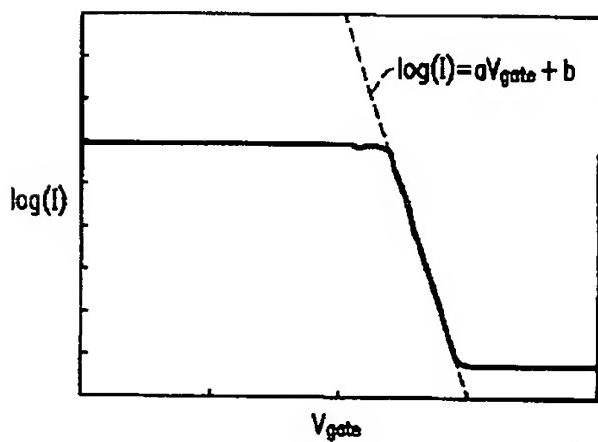
【図7】



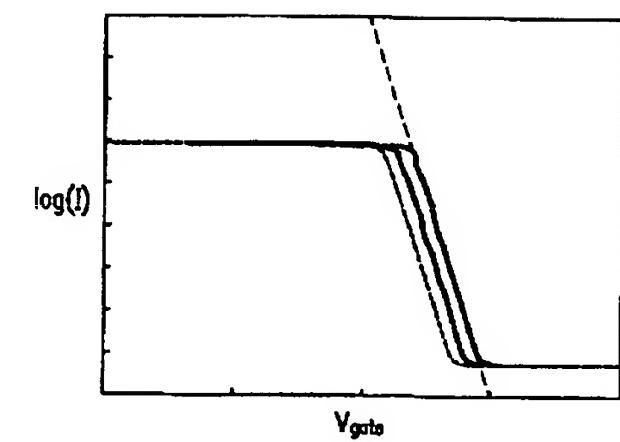
【図10】



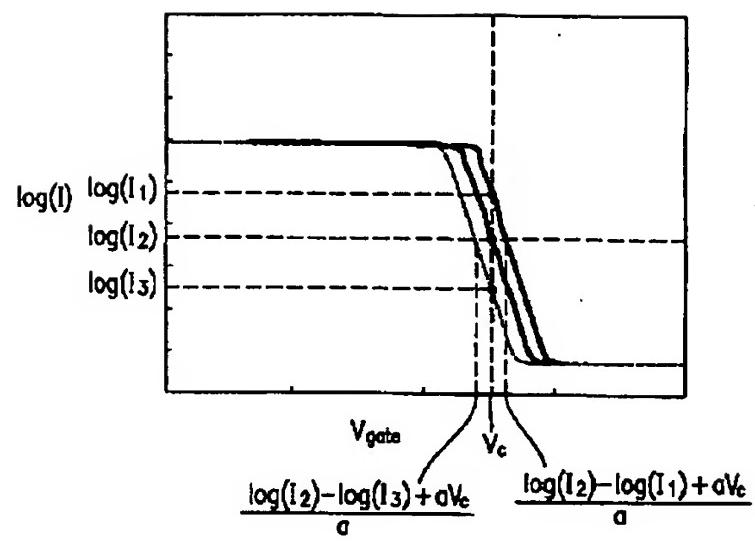
【図8】



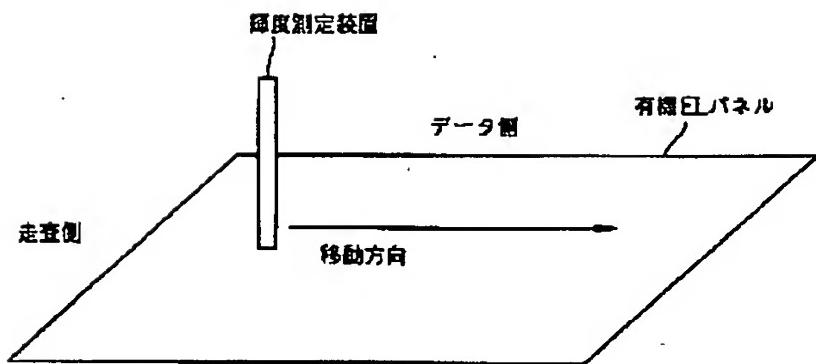
【図9】



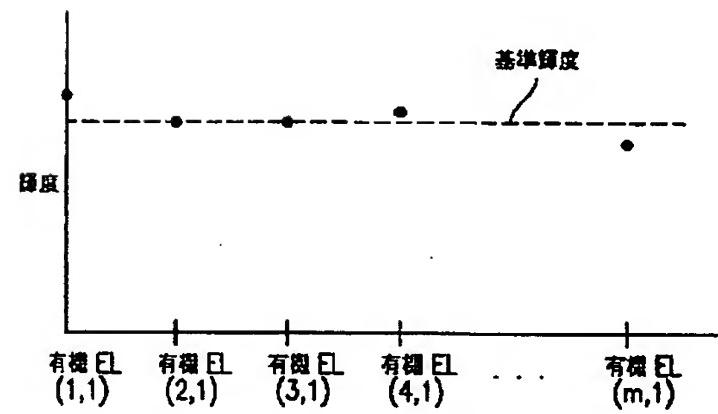
【図11】



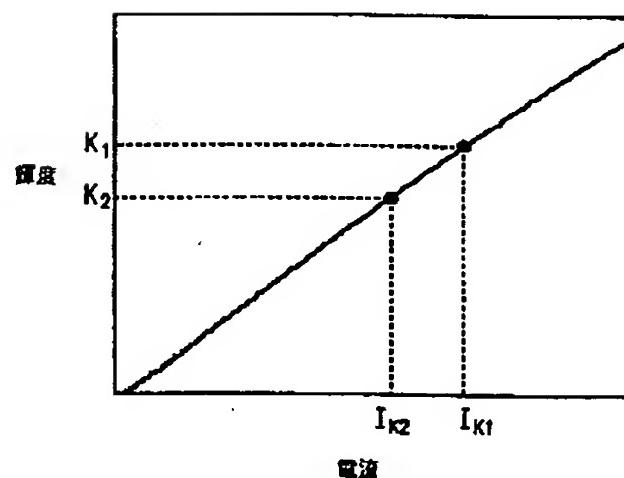
【図12】



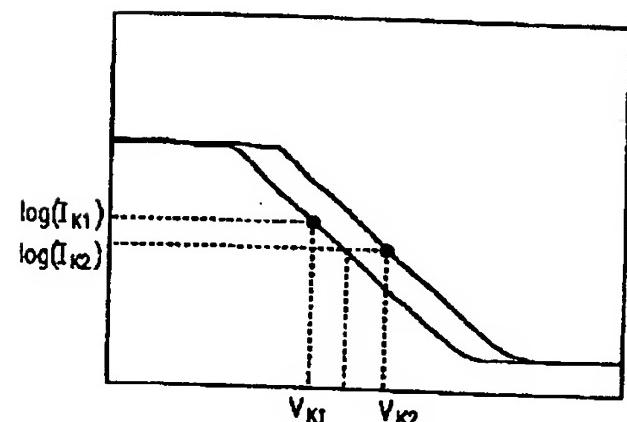
【図13】



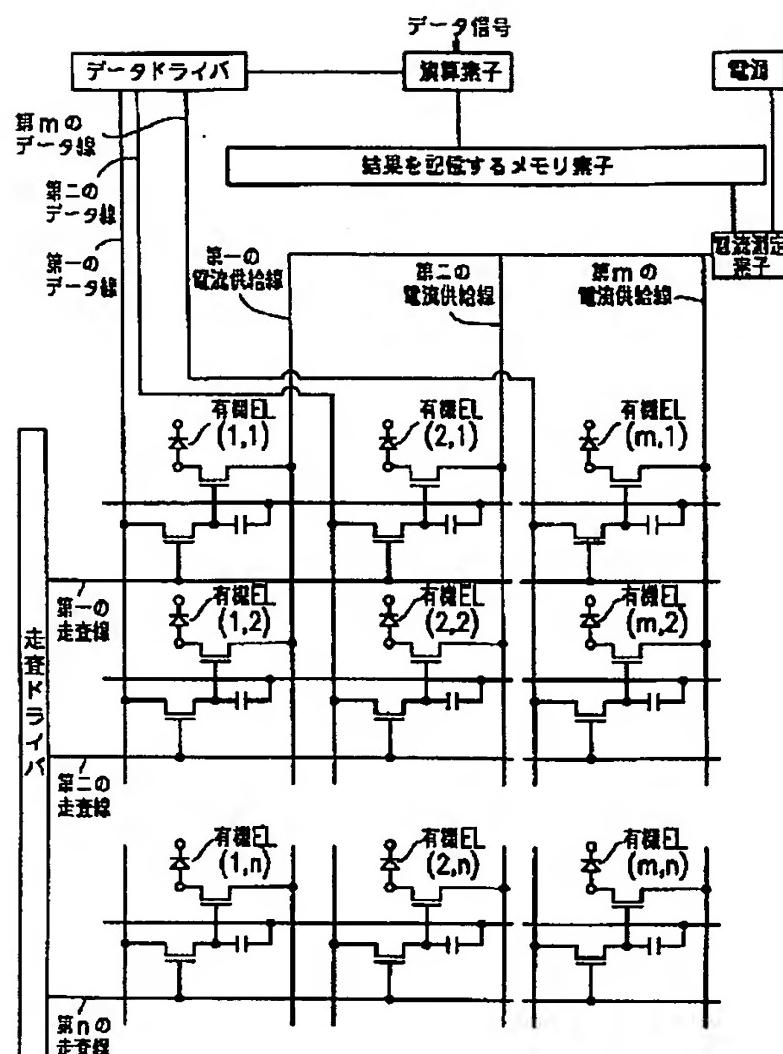
【図14】



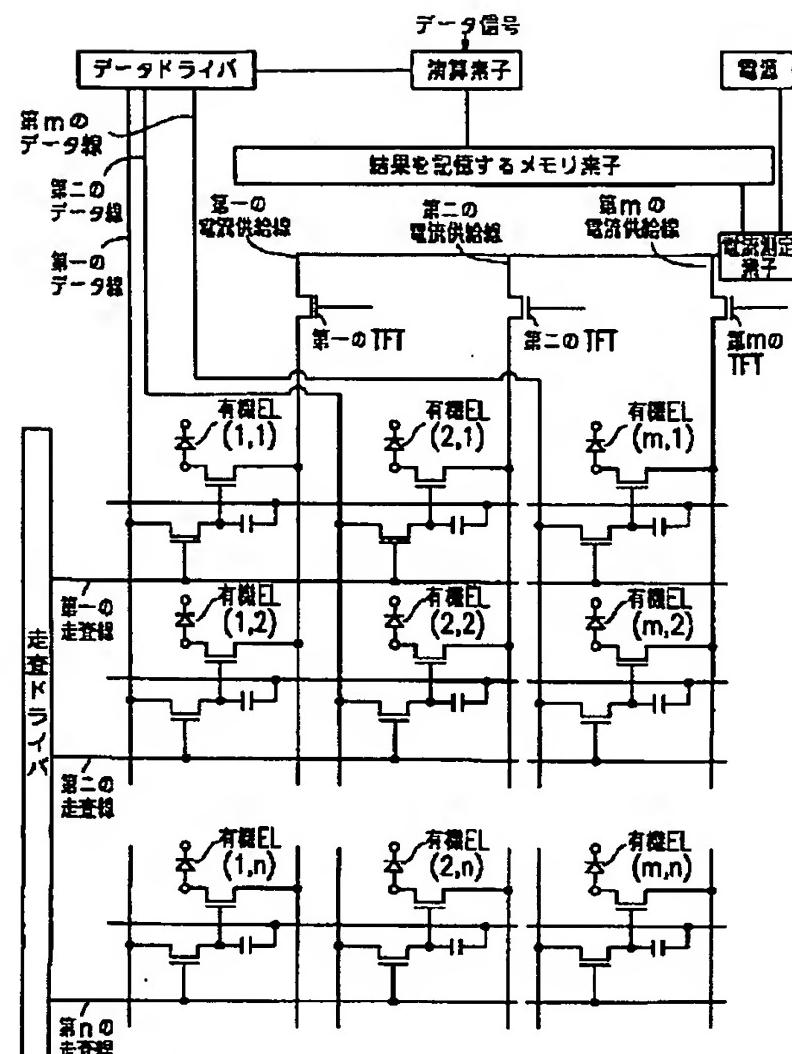
【図15】



【図16】



【図17】



フロントページの続き

(72)発明者 伊藤 信行
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ヤープ株式会社内

(72)発明者 向殿 充浩
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ヤープ株式会社内

F ターム(参考) 5C080 AA06 BB05 DD05 EE28 FF11
JJ02 JJ03 JJ05

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.